



การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นโดยวิธีจุ่มเคลือบ

SYNTHESIS OF TITANIUM DIOXIDE THIN FILM USING

DIP COATING TECHNIQUE



นางสาวเมรีรัตน์ ภะปุระ รหัส 54361602

นางสาวศศิธร เจริญปาละ รหัส 54365259

ปริญญาในพนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวกรรมวัสดุ ภาควิชาชีวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2557



## ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ การสังเคราะห์พิลเมบางไ泰เทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีจุ่มเคลือบ

ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวเมธีรัตน์ กะปุระ รหัส 54361602

นางสาวศศิธร เจริญปาลก รหัส 54365259

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์อุปัมภ์ นาครักษ์

สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาบัตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

.....กุล พากเพียร.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(อาจารย์อุปัมภ์ นาครักษ์)

.....ท. ศรีสุริยา.....กรรมการ  
(อาจารย์ศศิพล ตรีรุจิราภรณ์)

.....นฤมล สีผลไกร.....กรรมการ  
(อาจารย์นฤมล สีผลไกร)

.....ดร. ยุทธนา พูลสวัสดิ์.....กรรมการ  
(อาจารย์ยุทธนา พูลสวัสดิ์)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์โดยวิธีจุ่มเคลือบ		
ผู้ดำเนินโครงการ	นางสาวเมธีรัตน์ ภะปุระ	รหัส	54361602
	นางสาวศศิธร เจริญปาล	รหัส	54365259
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์อุปัมภ์ นาครักษ์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสดุ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2557		

---

## บทคัดย่อ

โครงการนี้มีความต้องการเพื่อศึกษาปฏิกริยาการเจือด้วยเหล็กในสัดส่วนต่าง ๆ โดยเมื่อทำการผลิตโดยการจุ่มเคลือบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กระเจ้าสไลด์ทำการจุ่มเคลือบสารจำนวน 7 รอบ และ มีการเจือสารเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ร้อยละต่าง ๆ ดังนี้ ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลที่ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction) เครื่องวิเคราะห์ยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรไฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒ด (Scanning Electron Microscope)

ผลการศึกษาพบว่าความสามารถดูดกลืนแสงในช่วงที่ตามองเห็น และในช่วงความยาวคลื่นยูวี (300-800 นาโนเมตร) ถูกวัดโดยเครื่องวิเคราะห์ยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรไฟโตมิเตอร์ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มบางนั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณสารเจือเหล็กคลอไรด์ ที่ใส่ลงไป โดยฟิล์มบางที่ไม่ได้ทำการเจือเหล็กคลอไรด์ นั้นจะมีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงที่ตามองเห็นได้ดีกว่าแบบไม่ได้ทำการเจือ ลักษณะสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒ด ที่กำลังขยาย 100,000 เท่า จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางที่ทำการเจือด้วยเหล็กคลอไรด์ ที่ปริมาณต่างกันพบว่าที่ปริมาณสารเจือยิ่งเพิ่มมากขึ้นทำให้ที่ผิวของฟิล์มนั้นจะไม่เกิดรอยแตก มีความเรียบขึ้นของผิวเมื่อเทียบกับกระจกที่ไม่ได้ทำการเจือสารแล้ว และเมื่อทำการเจือไปที่ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 พบร่วมกับการเจือที่ร้อยละ 10 เหมาะสมหากจะถูกนำไปใช้งานด้วยด้วยเหตุนี้ปริมาณสารเจือที่ใส่นั้นส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน การตรวจสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของฟิล์มไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่วัดโดยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางที่เราทำการสังเคราะห์ขึ้นมาดังนี้ มีรัตุไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เป็นเฟสอนาคตอยู่

<b>Project title</b>	Synthesis of Titanium Dioxide Thin Film Using Dip Coating Technique		
<b>Name</b>	Miss Mathreerat	Kapura	ID. 54361602
	Miss Sasithorn	Charoenpala	ID. 54365259
<b>Project advisor</b>	Mr. Auppatham	Nakaruk	
<b>Major</b>	Materials Engineering		
<b>Department</b>	Industrial Engineering		
<b>Academic year</b>	2014		

---

## Abstract

In this research, there is to study the reactivity of the compound with iron in various proportions. When produced by dip-coating the sample used in the study are glass slides will dip coating 7 sessions and doping ions chloride per cent as follows: 2% 4% 6% 8% and 10%. Then analyze the results. The instrument used in the study is X-Ray Diffraction, UV-VIS Spectrophotometer and Scanning Electron Microscope.

The study found that the ability to absorb light in the visible and ultraviolet wavelengths (300-800 nm) was measured by a UV-VIS Spectrophotometer shows that the light transmission of the film was changed depending on the amount of dopant  $\text{FeCl}_3$  into the film that are not laced with  $\text{FeCl}_3$  will be the most shining light and thin films that have made it the  $\text{FeCl}_3$  doping absorption in the visible range better than not doing doped. The Morphology by Scanning Electron Microscope at 100,000 times magnification. The results of the analysis showed that the thin films doped with different amounts of  $\text{FeCl}_3$  found that the amount of dopant increasing, making the surface of the film on the glass cracks, a smoother surface compared to glass that are not doped material. When doped to a 2 4 6 8 and 10% found that the doped with 10% will be appropriate to use. Therefore, the amount of dopant that directly affects the structure is clearly changing, determining the X-ray diffraction of titanium dioxide film measured by X-ray Diffractometer. The results showed that the thin films that we make up the synthetic are have the titanium dioxide phase analog.

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์อุปัมภ์ นาครักษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังให้ความรู้ คำปรึกษา แนวคิด ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลในการวิเคราะห์ ตลอดจนวิธีการในการแก้ปัญหา แก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ และให้กำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทศพล ตรีรุจิราภพวงศ์ อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ และอาจารย์นฤมล สีผลไกร ที่กรุณามาเสียสละเวลา มาเป็นคณะกรรมการสอบโครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโครงการนี้

ขอบคุณที่ ๑ ที่หน่วยงานศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เครื่องวิเคราะห์การเดี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ในการวิเคราะห์ขั้นงานจนสำเร็จ แนะนำวิธีเชือกปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ที่อยสนับสนุนในเรื่องกำลังใจ และค่าใช้จ่าย จนสามารถศึกษา และทำโครงการวิจัยเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณ พี่เพื่อน และน้องทุกคนที่ให้กำลังใจ และเคยช่วยเหลือ ในการทำโครงการนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นางสาวเมธีรัตน์ กะปุระ

นางสาวศศิธร เจริญปาล

พฤษภาคม 2558

# สารบัญ

	หน้า
บริบูรณ์โครงงานวิจัย .....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	ค
กิตติกรรมประกาศ .....	ง
สารบัญ .....	จ
สารบัญตาราง .....	ช
สารบัญรูป .....	ช
<b>บทที่ 1 บทนำ .....</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของโครงงาน .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน .....	1
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน .....	1
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ .....	2
1.5 ขอบเขตการดำเนินโครงงาน .....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงงาน .....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน .....	2
1.8 ขั้นตอน และแผนการดำเนินโครงงาน .....	3
<b>บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี .....</b>	<b>4</b>
2.1 สมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) .....	4
2.2 สารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) .....	7
2.3 กระบวนการจุ่มเคลือบ .....	8
2.4 กระบวนการโซลเจล .....	9
2.5 การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ ในด้านต่าง ๆ .....	11
2.6 เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ .....	13
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	22
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน .....</b>	<b>24</b>
3.1 ขั้นตอน และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการทำโครงงาน .....	24
3.2 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง .....	25
3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย .....	25

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ .....	28
4.1 ลักษณะของรากที่ทำการเจือ และไม่ได้ทำการเจือเทียบกับกระจาดธรรมชาติ.....	28
4.2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD).....	29
4.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) .....	33
4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางแสงจากเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer .....	37
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ .....	40
5.1 สรุปผลการทดลอง .....	40
5.2 ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ปัญหา .....	41
5.3 ข้อเสนอแนะ และการพัฒนา .....	41
5.4 การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต.....	41
เอกสารอ้างอิง .....	42
ภาคผนวก ก.....	45
ภาคผนวก ข.....	48
ประวัติผู้จัดทำโครงการ.....	52

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอน และแผนการดำเนินการ.....	3
2.1 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสอนาทาส .....	6
2.2 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสรูไทร์ .....	6
2.3 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสบรู๊คคิต์.....	6
3.1 ร้อยละสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ในไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณ 5.68 กรัม.....	26
4.1 ค่าปริมาณของสารเจือ กับ ค่าແຄບໜ່ອງວ່າງ (Band Gap) ในการทดลอง.....	39



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์.....	5
2.2 โครงสร้างผลึกของเฟสไทเทเนียมไดออกไซด์.....	5
2.3 กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสง .....	7
2.4 สารเหล็กคลอไรด์ (III) .....	8
2.5 กระบวนการจุ่มเคลือบ.....	9
2.6 การเปลี่ยนสถานะจากโซลเป็นเจล .....	9
2.7 กระบวนการโซลเจล .....	10
2.8 หลักการจาําเข็วโคคของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเงิน .....	11
2.9 ภาพถ่าย SEM ของ TiO <sub>2</sub> Nanotube arrays.....	13
2.10 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ( X-ray Diffract meter: XRD) .....	14
2.11 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ตามกฎของแบร์ก.....	14
2.12 เครื่องยูวี-วีส สเปกตรัมมิเตอร์.....	15
2.13 UV-VIS สเปกตรัม.....	17
2.14 ขั้นพลั่งงานของวัสดุกึ่งตัวนำ .....	18
2.15 การกระตุ้น และการปล่อยพลังงาน.....	18
2.16 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระดาด .....	20
2.17 การทำงานร่วมกันของอิเล็กตรอน.....	21
3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ .....	24
3.2 เครื่องจุ่มเคลือบ .....	26
3.3 เครื่องคนสารชนิดแม่เหล็ก (Magenetic Stirrer).....	27
4.1 ลักษณะของการจากที่ทำการเคลือบ .....	28
4.2 ร้อยละของสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) .....	29
4.3 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ได้ทำการเจือ เทียบกับ JCPDS ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เพสอนาคต.....	30
4.4 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 2 เทียบกับ JCPDS ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เพสอนาคต.....	30
4.5 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 4 เทียบกับ JCPDS ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เพสอนาคต.....	31
4.6 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 6 เทียบกับ JCPDS ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เพสอนาคต.....	31
4.7 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 8 เทียบกับ JCPDS ของไทเทเนียมไดออกไซด์ เพสอนาคต.....	32

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.8 ภาพการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไบทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 10 เทียบกับ JCPDS ของไบทเนียมไดออกไซด์ เพ夫โซนาทาส.....	32
4.9 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS ของกระจกที่ไม่ได้ทำการเจือ.....	33
4.10 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS ของกระจกที่ทำการเจือร้อยละ 10.....	34
4.11 ภาพกระจกที่ทำการเคลือบแล้วจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด.....	36
4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น กับ เปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านของแสงของฟิล์มบางไบทเนียมไดออกไซด์.....	37
4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานโฟตอน (Photonenergy) กับ ค่าการดูดกลืนของฟิล์มบางไบทเนียมไดออกไซด์.....	38



## บทที่ 1 บทนำ

### 1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการ

ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการศึกษา กันอย่างกว้างขวาง และได้นำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น [1-2] อีกทั้งไทเทเนียมเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีค่าซ่องว่างแบบพลังงาน (Energy Band Gap) สูง มีความความโปร่งแสง มีค่าดัชนีหักเห (Refractive Index) สูง และมีการดูดกลืนแสงต่ำในช่วงแสงตามองเห็น และอินฟราเรดใกล้ จึงนิยมนำมาใช้เป็นวัสดุเคลือบทางแสง นอกจานี้แล้ว พิล์มไทเทเนียม ยังถูกนำไปใช้เป็น ยูวีเซนเซอร์ ส่วนประกอบในเซลล์แสงอาทิตย์ จากสมบัติทางแสงของไทเทเนียมที่น่าสนใจ และมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เป็นที่นิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ และจุลินทรีย์ปนเปื้อนทั้งในอากาศ และในน้ำอย่างแพร่หลาย จึงมีผู้นิยมเคลือบ ไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนตัวกลางต่างๆ สำหรับกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น เคลือบลงบนแก้วไฟเบอร์ บันแปรงเมมเบรน บันเส้นไนแก้วสมชีลิกา หรือ บันกระจากส์แลร์

โดยเทคนิคการเคลือบพิล์มบางบันกระจากจะแบ่งได้ 2 วิธี คือ กระบวนการแบบแห้ง (Dry Process) เช่น การเคลือบแบบไอโรเฟย์ทางพิสิกส์ หรือ ทางเคมี สเป็ตเตอริง รีแอคทีฟพัลส์ เลเซอร์ และกระบวนการเคลือบแบบเปียก (Wet Process) เช่น ไมโครอาร์ค-ออกซิเดชัน ไฮโดรไทร์ молot และไทคนิกแบบโซลเจล ในการเคลือบแบบจุ่มเคลือบ หรือ การเคลือบแบบสปินอาจทำให้ได้พิล์มที่เคลือบผิวนวัสดุรองเคลือบเพียงด้านเดียวหรือสองด้าน ที่เทคนิคการเคลือบโดยการเตรียมพิล์มแบบโซลเจล และการเคลือบแบบจุ่มเคลือบเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาไม่สูง และกระบวนการเตรียมที่ง่าย เหมาะสมสำหรับการเตรียมพิล์มสองหน้า ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มสองหน้าและเหมาะสมแก่การปรับปรุงสมบัติพิล์มในภายหลังการเคลือบ

สำหรับโครงงานการสังเคราะห์พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ผลิตโดยวิธีจุ่มเคลือบ โดยหลักการในการเตรียมสารมีดังนี้ใช้ Titanium Isopropoxide 5.68 กรัม Dipropanol 84.32 มิลลิลิตร กรดน้ำส้ม 10 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย 100 มิลลิลิตร

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อสังเคราะห์พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีการเจือด้วยเหล็กในปริมาณต่าง ๆ
- 1.2.2 ศึกษาผลกระทบของปริมาณสารเจือที่มีต่อสมบัติโครงสร้างทางจุลภาค
- 1.2.3 ศึกษาผลกระทบของปริมาณสารเจือที่มีต่อสมบัติทางแสงของพิล์มบาง

### 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน

- 1.3.1 ทำการสังเคราะห์พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยเหล็ก
- 1.3.2 ทำการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างเชิงจุลภาคของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยเหล็ก
- 1.3.3 ทำการศึกษาสมบัติทางแสงของพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยเหล็ก

#### **1.4 เกณฑ์วัดผลสำเร็จ**

- 1.4.1 ฟิล์มบางที่เจือด้วยเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัมฐานวิทยา
- 1.4.2 ฟิล์มบางที่เจือด้วยเหล็กมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในย่างที่ตามองเห็นได้ดีกว่าฟิล์มบางที่ไม่มีการเจือ

#### **1.5 ขอบเขตในการดำเนินงานวิจัย**

##### **1.5.1 ตัวแปรควบคุม**

- 1.4.1.1 กระจกสไลด์
- 1.4.1.2 กระบวนการจุ่มเคลือบ (Dip Coating)
- 1.4.1.3 ความหนาของฟิล์มบางอัตราการจุ่ม 7 รอบ
- 1.4.1.4 อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาฟิล์มบางที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส
- 1.4.1.5 ปริมาณสารตั้งต้นของไธเทเนียมไอโซโพกอกไซด์ คือ 5.68 กรัม
- 1.4.1.6 ปริมาณสารเจือเหล็กคลอร์ไรด์ (III) คือ ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10

##### **1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา**

- 1.5.2.1 ศึกษาลักษณะสัมฐานวิทยาของฟิล์มบางที่ได้จากการทดลอง
- 1.5.2.2 ศึกษาสมบัติทางแสง

#### **1.6 สถานที่ในการดำเนินการวิจัย**

- 1.6.1 ห้อง TC413 อาคารมหาธรรมราชาที่วิจัยวัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ ทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.6.2 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 1.6.3 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#### **1.7 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย**

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558

## 1.8 ขั้นตอน และแผนการดำเนินการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอน และแผนการดำเนินการ

ลำดับ	การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา										
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
1.8.1	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ไฟเทเนียมไดออกไซด์ และกระบวนการผลิต แบบจุ่มเคลือบ			↔								
1.8.2	เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลองการจุ่มเคลือบ			↔								
1.8.3	ทำการทดลองการจุ่ม เคลือบบนกระจกสไลด์				↔							
1.8.4	ตรวจสอบฟิล์มบางที่ เจือตัวยเหล็ก มีการ เปลี่ยนแปลงลักษณะ สัณฐานวิทยา							↔				
1.8.5	วิเคราะห์ และสรุปผล การทดลอง พร้อม จัดทำรายงาน							↔				

## บทที่ 2

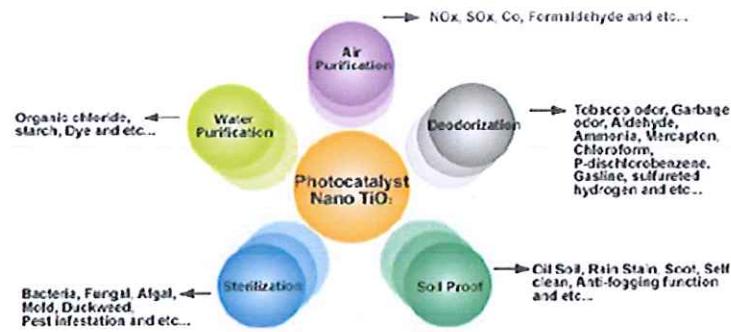
### หลักการ และทฤษฎีเบื้องต้น

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฟิล์มบางไหเทเนียมได้ออกไซด์โดยวิธีการจุ่มเคลือบ ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วย สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของไหเทเนียมได้ออกไซด์ สารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) กระบวนการจุ่มเคลือบ กระบวนการโซลเจล และการประยุกต์ใช้งานไหเทเนียมได้ออกไซด์ ดังนี้

#### 2.1 สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของไหเทเนียมได้ออกไซด์ ( $TiO_2$ )

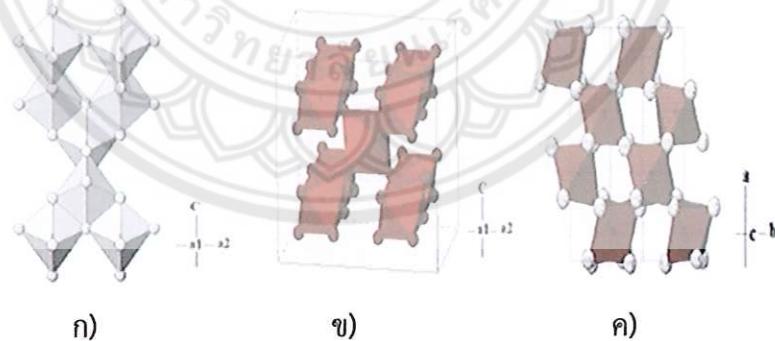
วัสดุ nano ไหเทเนียมได้ออกไซด์ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำไปใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ ตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง และเซลล์เชื้อเพลิง ไหเทเนียมได้ออกไซด์สามารถขึ้นรูปเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุที่เป็นที่รู้จักว่า “วัสดุ nano” ที่มีโครงสร้างแบบต่าง ๆ เช่น อนุภาคนาโน ท่อนาโน เส้นใยนาโน แผ่นนาโน และลดนาโน ซึ่งขนาดอนุภาค และโครงสร้างของวัสดุ nano ไหเทเนียมได้ออกไซด์นี้อยู่กับวิธี และสภาพที่ใช้ในการสังเคราะห์นอกจากนี้การเจือวัสดุ nano ไหเทเนียมได้ออกไซด์ด้วยไอออนของโลหะออกไซด์ของโลหะ และธาตุกลุ่มอัลคาไลน์เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งสูงขึ้น

ไหเทเนียมได้ออกไซด์ ( $TiO_2$ ) หรือ ไหเทเนียมเป็นสารประกอบออกไซด์ของโลหะไหเทเนียม ซึ่งอยู่ในกลุ่มโลหะทรายซิชั่นไหเทเนียมได้ออกไซด์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการนำมาประยุกต์สำหรับการใช้งานในด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีความเสถียรต่อสารเคมีไม่มีความเป็นพิษ และราคาไม่แพงมากดังรูปที่ 2.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานรูปอื่น เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม (Photocatalysis) เป็นต้น เนื่องจากไหเทเนียมได้ออกไซด์มีค่าดัชนีการหักเหของแสงสูงจึงถูกนำมาใช้เป็นสารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ ซินดิลิคอน (Silicon Solar Cell) และในอุปกรณ์ทางด้านการมองเห็นชั้นดินแกร่นบาง (Thin Film Optical Device) หลายชนิด ไหเทเนียมได้ออกไซด์ยังถูกนำมาใช้เป็นตัวตรวจสอบกําช (Gas Sensor) เนื่องมาจากมีค่าการนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตามองค์ประกอบของกําชที่สภาวะบรรยากาศ เช่น สามารถใช้ตรวจสอบกําชของอากาศบนมอนอกไซด์ และมีไหเทเนียม เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจากไหเทเนียมได้ออกไซด์สามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้จึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ เช่น กระดูกเทียม เป็นต้น



รูปที่ 2.1 การประยุกต์ใช้งานไฟเทเนียมไดออกไซด์ [3]

ไทเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) มีเลขอะตอม 22 และน้ำหนักอะตอม 47.90 กรัมต่้อมลโดยทั่วไปไทเนียมที่พบในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของเฟสต่าง ๆ โดยเฟสที่พบหลักๆ มีอยู่ 3 เฟส คือ เฟสอนาคต รูไทร์แลน และบรูคโคิด ดังรูปที่ 2.2 โดยมีสมบัติทางกายภาพตามตารางที่ 2.1 ถึง 2.3 ไทเนียมไดออกไซด์มีสมบัติเป็นโพโตแคนเทลลิสต์ที่สามารถนำมาระยุกติใช้ในการย่อยสลายสารที่เป็นอันตรายในน้ำ หรือ อากาศ เนื่องจากเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงแล้วจะเกิดปฏิกิริยาโพโตแคนเทลลิส (*Photo catalysis*) ได้ นอกจากนั้นยังถูกประยุกติใช้ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย หรือ ราได้ส่วนใหญ่แล้วการเตรียมสารหรือสังเคราะห์มักอยู่ในรูปฟิล์มที่เคลือบนวัสดุหรือเป็นผงอนุภาคระดับนาโนโดยมีวิธีผลิตหลายวิธี เช่น โซล-เจล (Sol-Gel) เป็นต้น [4]



รูปที่ 2.2 โครงสร้างผลึกของเฟสไทเทนเนียมไดออกไซด์ [5]

- ก) อนาคต
  - ข) รูปแบบ
  - ค) บริคคิต์

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสอนาคต [6]

ชื่อวัสดุ	อนาคต		
องค์ประกอบทางเคมี	$\text{TiO}_2$		
โครงสร้างผลึก	เตต拉โภโนล		
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	25		
$\alpha(\text{deg})$ , $\beta(\text{deg})$ , $\gamma(\text{deg})$	90	90	90
อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตรอะตอมในหน่วย เซลล์ และปริมาตรหน่วยเซลล์	136.3		
ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศก์เมตร)	3.89		

ตารางที่ 2.2 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสรูไทร์ [7]

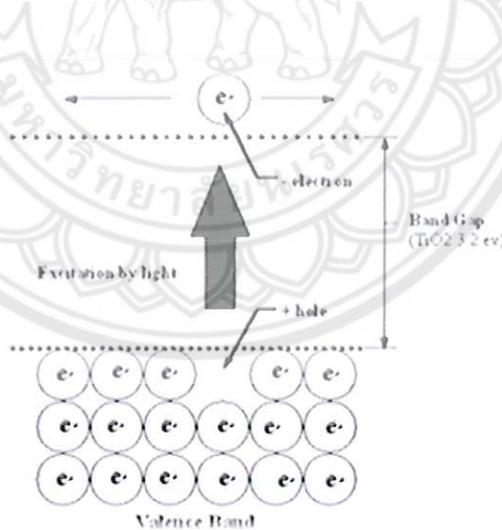
ชื่อวัสดุ	รูไทร์		
องค์ประกอบทางเคมี	$\text{TiO}_2$		
โครงสร้างผลึก	Tetragonal		
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	25		
$\alpha(\text{deg})$ , $\beta(\text{deg})$ , $\gamma(\text{deg})$	90	90	90
อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตรอะตอมในหน่วย เซลล์ และปริมาตรหน่วยเซลล์	62.42		
ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศก์เมตร)	4.25		

ตารางที่ 2.3 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้างของเฟสบรู๊คไคเตอร์ [7]

ชื่อวัสดุ	บรู๊คไคเตอร์		
องค์ประกอบทางเคมี	$\text{TiO}_2$		
โครงสร้างผลึก	Orthorhombic		
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	25		
$\alpha(\text{deg})$ , $\beta(\text{deg})$ , $\gamma(\text{deg})$	90	90	90
อัตราส่วนระหว่าง ปริมาตรอะตอมในหน่วย เซลล์ และปริมาตรหน่วยเซลล์	257		
ความหนาแน่น (กรัม/ลูกบาศก์เมตร)	4.13		

ถึงแม้ว่าโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมได้ออกใช้ด้วยหลายชนิดแต่เฟสอนาคต และรูไทร์ เป็นโครงสร้างผลึกที่พบเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วโครงสร้างผลึกอนาคต สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโครงสร้างผลึกรูไทร์ได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 600 องศาเซลเซียส [8] ในปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอนาคตไปเป็นรูไทร์เป็นอย่างมากเนื่องจากโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมได้ออกใช้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากตัวแปรหนึ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งาน เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบปกติ (ไม่ใช่แสงร่วม) หรือ เซรามิกที่ใช้ทำเยื่อแผ่นบาง (Membrane) โดยนอกจากอุณหภูมิแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผล

กระบวนการต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกดังกล่าว ได้แก่ ความดัน ปริมาณของผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก และขนาดของผลึก ในการประยุกต์ใช้ไฟเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม โครงสร้างผลึกทั้งอนาไโรส และรูไทร์ เป็นที่นิยมนำมาศึกษา กันโดยทั่วไป สำหรับปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมโดยปกตินั้น โครงสร้างผลึกอนานาทัสให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงกว่า โครงสร้างผลึกรูไทร์ โดยมีตัวแปรหลายตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของแต่ละโครงสร้างผลึกของไฟเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ พื้นที่ผิว การกระจายตัวของรูพรุน ขนาดของอนุภาคผลึก และที่สำคัญมาก คือ วิธีการที่ใช้ในการสังเคราะห์ผลึกไฟเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างผลึกไฟเทเนียมไดออกไซด์จัดได้ว่าเป็นสารกึ่งตัวนำนิวเคลียน (N-Type Semiconductor) ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมที่เป็นสารกึ่งตัวนำนั้นจะมีความสามารถในการดูดซับสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยา 2 ชนิดไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และรีดักชัน (Oxidation And Reduction Reactions) โดยการกระตุ้นด้วยการดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับหรือมากกว่าค่าแอนด์องว่างพลังงาน (Band Gap Energy) ความสามารถของสาร กึ่งตัวนำที่จะถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยาที่ถูกดูดซับไว้แล้วขึ้นอยู่กับตำแหน่งของແບບซ่องว่างพลังงานของสารกึ่งตัวนำ และตำแหน่งของศักย์พลังงานในการเกิดรีดอกซ์ (Redox) ของสารที่ถูกดูดซับ โดยปกติแล้วระดับของพลังงานที่ต่ำที่สุดของແບบการนำไฟฟ้า (Conduction Band) จะเป็นระดับของศักย์พลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรียดักชันด้วยอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้น (Excited Electron) ในทางกลับกัน ระดับของพลังงานที่สูงที่สุดของແບบวาเลนซ์ (Valence Band) จะเป็นระดับศักย์พลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยโฮล (Hole) ที่เหลืออยู่หลังจากที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นไปแล้ว ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารกึ่งตัวนำไฟเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสง [9]

## 2.2 สารเจือเหล็กคลอไรด์ (III)

เหล็กคลอไรด์ (III) เรียกอีกอย่างว่า เฟอร์ริคคลอไรด์ มีคุณสมบัติทางเคมี ในอุตสาหกรรมสารประกอบเคมีที่มีสูตร  $\text{FeCl}_3$  สีของผลึกเหล็กคลอไรด์ (III) เป็นผลึกสีขาวบริสุทธิ์ หรือ เขียว หรือเหลืองจุดเดือด เท่ากับ 1012 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว เท่ากับ 674 องศาเซลเซียส [10] คลอไรด์ขึ้นอยู่กับมุมมอง โดยการเกิดแสงสะท้อนผลึกจะปรากฏเป็นสีเขียวเข้ม แต่ด้วยแสงที่ส่องพากเพียจ

ปรากฏเป็นสีม่วงแดงปราศจากเหล็กคลอไรด์ (III) ที่เป็นเดลิคิวส์เกนต์ กล้ายเป็นไฮโดรเจน-คลอไรด์ละ่องในอากาศชั้น มันไม่ค่อยเป็นที่สังเกตในรูปแบบตามธรรมชาติ

### 2.2.1 ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

2.2.1.1 ความคงตัวทางเคมี: สารนี้มีความเสถียร

2.2.1.2 สารที่เข้ากันไม่ได้: กรด เอทิลินออกไซด์ โพแทสเซียม โซเดียม

2.2.1.3 สภาพที่ควรหลีกเลี่ยง: ความชื้น

2.2.1.4 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: ไฮโดรเจนคลอไรด์ และคลอรีน

### 2.2.2 การจัดเก็บ

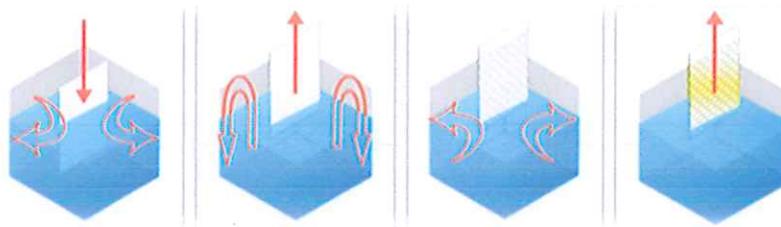
ควรเก็บในบีเวนที่เย็น และแห้งเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเนื่องจากสารมีลักษณะเป็นผงหากปิดไม่มิดชิดความชื้นเข้าไปทำให้สารมีประสิทธิภาพลดลงด้วย เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ ทำความสะอาดให้หัวลงหลังจากสัมผัสกับสารนี้



รูปที่ 2.4 สารเหล็กคลอไรด์ (III) [10]

### 2.3 กระบวนการจุ่มเคลือบ (Dip Coating)

กระบวนการจุ่มเคลือบเป็นเทคนิคในการเคลือบผิววัสดุวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายราคาถูก นิยมใช้ในการเคลือบผิววัสดุต่าง ๆ สามารถเคลือบวัสดุที่มีรูปร่างพื้นฐานจนถึงวัสดุที่มีความซับซ้อนได้โดยการจุ่มวัสดุฐาน (Substrate) ลงในของเหลวซึ่งเป็นสารเคลือบ ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการเตรียมวัสดุนาโนโดยการนำสารละลายที่เตรียมได้จากการอ่อนน้ำ ทำการจุ่มเคลือบลงบนตัวกลางที่ต้องการ ทำให้เกิดการเรียงตัวของอนุภาคบนพื้นผิวของตัวกลางที่ต้องการจึงเกิดเป็นฟิล์มบางขนาดนาโนขึ้น จากนั้นนำฟิล์มบางนาโนที่ได้ไปให้ความร้อนโดยการเข้าเตาอบ เพื่อทำให้ฟิล์มสามารถยึดติดบนผิวของวัสดุที่ใช้เคลือบได้ โดยความหนาของฟิล์มที่เคลือบในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับอัตราในการจุ่ม และความหนืดของสารเคลือบเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการจุ่มเคลือบ



รูปที่ 2.5 กระบวนการจุ่มเคลือบ [11]

## 2.4 กระบวนการใช้ลเจล

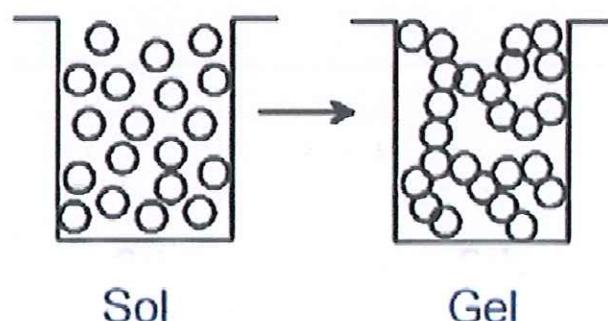
กระบวนการผลิตโดยวิธี Sol-gel เป็นกระบวนการผลิตที่มีประโยชน์หลายอย่างในการผลิตเซรามิค และแก้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัสดุที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง โดยทั่วไปกระบวนการ Sol-gel เป็นกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่ เรียกว่า Sol ซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปของสารแขวนลอยที่ มีอนุภาคประมาณ 0.1 ถึง 1 ไมครอนเป็นของแข็งที่เรียกว่า Gel [12]

### 2.4.1 กระบวนการใช้ลเจลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน [13]

2.4.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การผสมสารตั้งต้นให้เป็นสารละลายที่มีความหนืดต่ำ ได้แก่สารอนุพันธ์ของโลหะ (อินทรีย์) ให้สารมีลักษณะเป็นเนื้อดีกว่ากันถึงขั้นระดับโมเลกุล เพื่อให้ได้ โซล ที่เป็นสารประกอบออกไซด์ เช่น โซลของโลหะออกไซด์

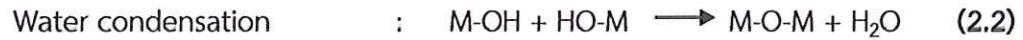
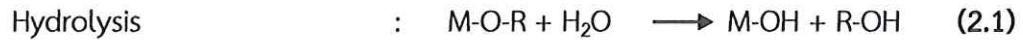
2.4.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การเข้ามต่อเป็นร่างแหของโซลให้มีความสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดเป็นเจล ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ สำคัญมากสำหรับการทำให้สารเคมีเป็นเนื้อดียว ขณะทำให้แห้ง

2.4.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การขึ้นรูปขณะที่สารเป็นเจล ให้เป็นวัสดุชั้นใหญ่ (Bulk Materials) มีลักษณะกลวง (Hollow Materials) เฟอร์บ (Fiber) หรือ วัสดุเคลือบผิว (Coating Materials) เป็นต้น ก่อนนำไปเผา



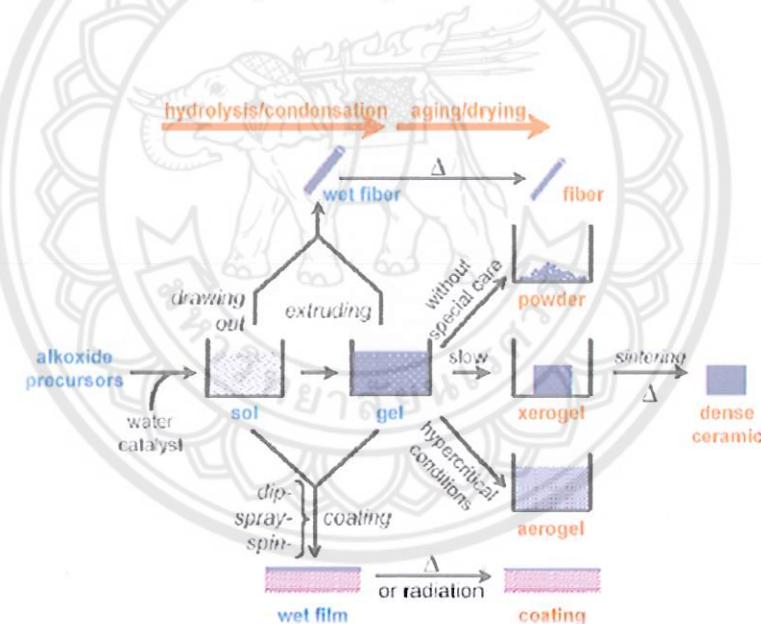
รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนสถานะจากโซลเป็นเจล [12]

ปฏิกิริยาที่สำคัญในกระบวนการ Sol-Gel มี 3 ปฏิกิริยา คือ Hydrolysis, Water Condensation และ Alcohol Condensation ดังสมการ มีปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ pH ตัวเร่งปฏิกิริยาอัตราส่วนโมลของน้ำ, โลหะ และอุณหภูมิ ดังนั้น การควบคุมปัจจัยเหล่านี้ในสภาวะที่ต่างกันจะทำให้ชล และเจลที่ได้มีสมบัติ โครงสร้างที่ต่างกัน



เมื่อ M แทนโลหะ ได้แก่ Si, Zr, Ti, Al, Sn, Ce และ OR แทน Alkoxyl group

ในการบวนการผลิตทั้งจากสภาวะที่เป็น Sol และ Gel เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำให้แห้งจะได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เส้นใย (Fiber) แอโรเจล (Aerogel) เซอร์เจล (Xerogel) ผง (Powder) และฟิล์มบาง เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป



รูปที่ 2.7 กระบวนการโซลเจล [12]

## 2.4.2 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดเจล

2.4.2.1 การทำให้ประจุที่พิวอนุภาคเป็นกลาง สามารถทำได้โดยการปรับความเป็นกรด-ด่างหรือ พีเอชของระบบ

2.4.2.2 การเกาหตัว

2.4.2.3 การเกิดปฏิกิริยาควบแน่นต่อเนื่องจากหมู่ที่ว่องไวบนพิวอนุภาค

2.4.2.4 การเกิดเจล มีผลให้ความหนืดของสารเพิ่มขึ้น ดังนั้น ตัวแปรที่มีผลต่อปฏิกิริยาการเกิดเจล คือ สารตั้งต้น เช่น เกลือออกไซด์ แอกโคไซด์

2.4.2.5 ສភາວະທີໃໝ່ໃນການທຳປົງກິຣີຍາ ໄດ້ແກ່ ຕັ້ງທຳລະລາຍ ອຸນຫຼຸມຕົວເຮັດປົງກິຣີຍາ ແລະພື້ເອຊ

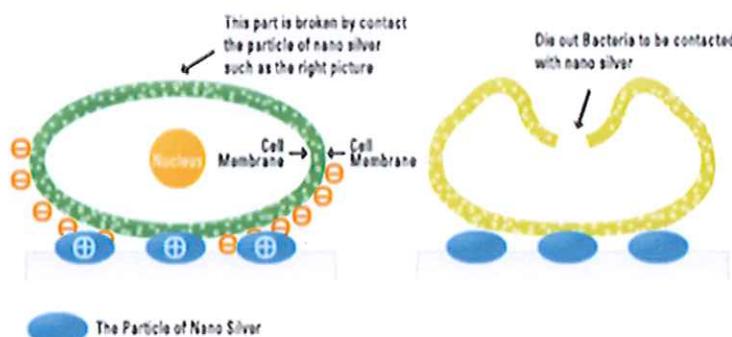
2.4.2.6 ຕັ້ງແປຣເຈິງກລ ເຊັ່ນ ກາຮກວນ ກາຮກລັ້ນໄໜໂລກລັບ ກາຮໃໝ່ອທຣາໂຫຼືນຒກ

## 2.5 ກາຮປະຢຸກຕີໃໝ່ຈານໄທທີເນີຍໄດ້ອອກໃ່ຈົດ ໃນດ້ານຕ່າງ ๆ

ກາຮປະຢຸກຕີໃໝ່ຈານໄທທີເນີຍໄດ້ອອກໃ່ຈົດທີ່ໃໝ່ໃນຈານດ້ານຕ່າງ ๆ ເຊັ່ນ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ບຳບັດນໍ້າເສີຍ ອາກາສເສີຍ ແລະດ້ານອື່ນ ๆ ອົກຫລາຍດ້ານກຳລັງໄດ້ຮັບກິດຈະກຳ ແລະນຳໄປປະຢຸກຕີໃໝ່ ຈາກກັນອ່າຍແພຣ່ຫລາຍດັ່ງນີ້

### 2.5.1 ກາຮຈ່າເຂົ້ວໂຮກ

ຫລັກກາຮ ແລະປະສິທິພາພໃນກາຮຈ່າເຂົ້ວໂຮກຂອງໄທທີເນີຍໄດ້ອອກໃ່ຈົດສິ່ງເປັນສາຣໂໂໂຕແຄ-ຕະລິສົດທີ່ມີປະສິທິພາພທີ່ດີມາກນ້ອຍເພີ່ງໄດ ປັຈຍີທີ່ສຳຄັງ ຄື່ອ ສາຮເຈືອ ແລະປະມິມານຂອງສາຮເຈືອ ໂດຍສາຮເຈືອທີ່ມີປະສິທິພາພໃນກາຮຈ່າເຂົ້ວໂຮກມີຍູ້ດ້ວຍກັນຫລາຍຕົວ ເຊັ່ນ ເຈີນ ແລ້ວ ແທວງແດງ ເປັນຕົ້ນ [4] ໂດຍສາຮດັ່ງກ່າວເມື່ອພົມກັບໄທທີເນີຍໄດ້ອອກໃ່ຈົດ ແລະເຕັ້ງຕົ້ນໃຫ້ມີຂາດອນວາຄະດັບນາໂນຈະໄປປະຢຸກຕີກັບພັນໜັງເຊີລົດຂອງເຂົ້ວໂຮກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີປົງກິຣີຍາຕອບໄຕ້ຍ່າງມາກກັບໂປຣຕິນ ສິ່ງຈຸລິນທີ່ມີອົງກົດປະກອບຂອງໂປຣຕິນເປັນອົງກົດປະກອບຫລັກ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອອຸນຸກາຂນາດຈົ່ວສັມຜັກກັບຈຸລິນທີ່ມີນັ້ນຈະໄປເກາະທີ່ພັນໜັງເຊີລົດແລະແທຽກເຂົ້າໄປກາຍໃນໂດຍຈະໄປເກາະກັບໜູ້ -SH (Sulfhydryl) ຂອງເອັນໄໝ໌ສິ່ງຈະມີຜລຕ່ອຮະບົມເນັກໂປຣລິ້ນມີກົດປະກອບຫລັກ ແລະຮະບົມຍ້າຍຊັບສຕຣາທ ໃນເຢື່ອຫຼຸມເຊີລົດ ຍຶ່ງໄປກວ່ານັ້ນຍັງເກີດກາຍັບຍັງການເພີ່ມຈຳນວນແລະກາເຈົ້າຕົບໂຕຂອງຈຸລິນທີ່ມີນັ້ນຈະໄປໃຫ້ຈຸລິນທີ່ມີນັ້ນ ຮີ່ວເຂົ້ວໂຮກຕ່າງ ๆ ໄນມີສາມາດດຳຮັບຮົວໃຈໄປໄດ ແລະຕາຍໃນທີ່ສຸດ



ຮູບທີ 2.8 ຫລັກກາຮຈ່າເຂົ້ວໂຮກຂອງໄທທີເນີຍໄດ້ອອກໃ່ຈົດທີ່ເຈືອດ້ວຍເຈີນ [4]

### 2.5.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่จุดเริ่มในปี 1970 จนถึงปัจจุบันจำนวนสารปนเปื้อนมากกว่า 1000 ชนิด [14] ได้ถูกนำมาทดสอบ และพบว่าสามารถใช้กระบวนการการโพโต-แคตالิซิสในการกำจัดสารเหล่านั้นได้อย่างดีเยี่ยง ทั้งในส่วนของสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นสารในกลุ่มของฟีนอล ยาฆ่าแมลง สี สารในกลุ่มของ เบนซินโกลูอีนเอธิลเบนซิล และไฮคลีนซึ่งจากการปนเปื้อนของน้ำมันตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีคลอรีน เช่น ไตรคลอไรอีลีน และคลอโรฟอร์ม เป็นต้น และสารอินทรีย์ในกลุ่มโลหะหนักการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในการเป็นโพโตแคตัลิสต์เพื่อสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรืออากาศ พบร่วมกับการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนที่สังเคราะห์ด้วย วิธีไฮโดรลิซิสซึ่งใช้แอลกอฮอล์ และน้ำเป็นตัวทำละลายในการสลายตัวของเมทิลีนบูลูในอัตราของเมทิลีนบูลู 1200 มิลลิลิตรต่อผงไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 กรัมแล้วให้แสงจากหลอดยูวีวัดการดูดกลืนแสงที่ 665 นาโนเมตรด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้นขนาดของอนุภาคของอนาไทส์ และรูไอล์เพิ่มขึ้นด้วย

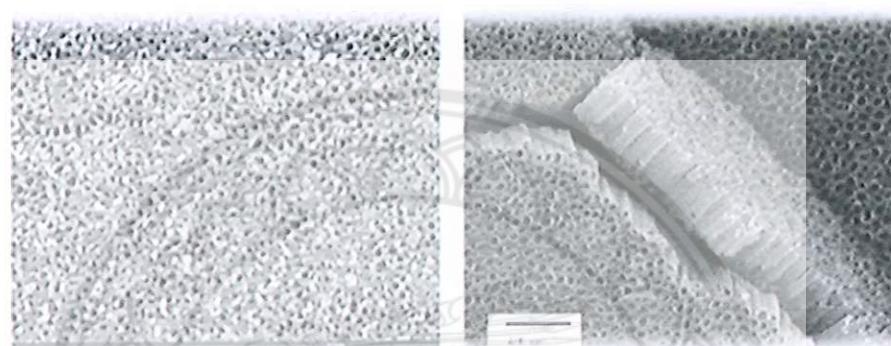
### 2.5.3 ด้านการแยกน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

การนำไทคานิกโพโตแคตัลิซิมาใช้กับการบำบัดน้ำอาจเป็นผลจากการศึกษาวิจัยมากกว่า 10 ปีหลักการที่นิฐานของเทคนิคโพโตแคตัลิซิสเริ่มจากการที่แสงไปกระตุ้นอิเล็กตรอนที่แถบเวลเอนซ์ (Valence Band) ของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นสารประกอบกึ่งตัวนำซึ่งแขวนลอยอยู่ในน้ำที่มีสิ่งเจือปนหลุดออกจากตัวแทนร่องส่งผลให้คุณภาพของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่หลุดไป และหลุมประจุบวก (Hole) ซึ่งเป็นช่องว่างที่ไม่มีอิเล็กตรอน และมีประจุบวกสามารถสร้างพลังงานความร้อนกลับมารวมตัวกัน หรือ ทำปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยที่หลุมประจุบวกจะทำปฏิกิริยากับน้ำ และหมู่ไฮดรอกซิล เพื่อทำให้เกิดไฮดรอกซิลแรดิคัล (Hydroxyl Radical) ซึ่งเป็นตัวออกซิเดชันที่รุนแรงสามารถนำไปทำให้ไม่เกิดข้อหักของสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่แทบทุกตัวออกกล้ายเป็นน้ำ และก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) และผลิตภัณฑ์อนินทรีย์อื่น ๆ ส่วนอิเล็กตรอนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ละลายอยู่ทำให้เกิดซุปเปอร์ออกไซด์แอนิโอน ( $\text{O}_2^-$ ) ซึ่งสามารถทำให้เกิดไฮดรอกซิลแรดิคัลได้หลังจากปฏิกิริยาผ่านไปหลายขั้นตอนในอีทางหนึ่งอิเล็กตรอนสามารถลดปริมาณโลหะบางชนิดที่ละลายอยู่ด้วยได้

### 2.5.4 ด้านโซลาร์เซลล์

ไทเทเนียมไดออกไซด์จัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของเซมิคอนดัคเตอร์ มีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในโซลาร์เซลล์มากขึ้น เช่น นำไปเคลือบบนอิเล็กโทรดเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นราคาของโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพง เพราะ กระบวนการผลิตต้องใช้ต้นทุนสูง และให้ประสิทธิภาพต่ำเมื่อ

เปรียบเทียบราคา กับ ปริมาณ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนั้น มีการวิจัย และ พัฒนาการทำงานของโซลาร์เซลล์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำเจอร์เมเนียม (Ge) ผสมลงไป ในไทเทเนียม ได้อกไซด์ เพื่อทำเป็น Quantum Dot โซลาร์เซลล์ การนำชิลิกา และไทเทเนียม- ไดออกไซด์ เคลือบบน Si โซลาร์เซลล์ เพื่อปรับปรุงสมบัติ ด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การเตรียมไท- ทาเนียม ไดออกไซด์ ให้อยู่ในรูปของท่อนาโน่ ที่ผลิตด้วย วิธี RF Sputtering ดังรูปที่ 2.9 สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของโซลาร์เซลล์ ได้ เช่น กัน โดยเพิ่ม Electron Lifetime และประสิทธิภาพการ เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า [15] ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้อย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 2.9 ภาพถ่าย SEM ของ TiO<sub>2</sub> Nanotube Arrays [15]

#### 2.5.5 ด้านทำความสะอาดตัวเอง (Self - cleaning)

มีสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง ผนังด้านนอกของอาคารที่ถูกปักคลุมด้วยคราบ  
เขม่าจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำมัน เมื่อผนังตึกถูกทำด้วยไฟเทเนียม-  
ไดออกไซด์ซึ่งมีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง จะทำให้ผนังมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเอง  
โดยเมื่อถูกกระตุนด้วยแสง ไฟเทเนียมไดออกไซด์จะทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งฝุ่นผง  
ต่าง ๆ ที่เกาะติดอยู่กับผนัง และจะถูกชะล้างออกจากผนังอย่างง่ายได้ เมื่อผนังตกลงมาทำให้ผนังตึกดู  
สะอาดและใหม่อยู่เสมอ

## 2.6 เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์

### 2.6.1 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยงเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffractometer)

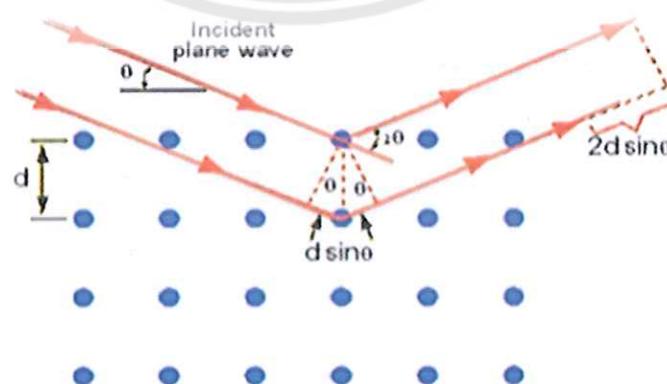
XRD ย่อมาจากคำว่า X-ray Diffractrometer มีชื่อภาษาไทยว่า “เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรกชัน” ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จะอาศัย หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เมื่อถูกกระทำต่อบริเวณ หรือ อนุภาคจะเกิดการหักเหของลำรังสี สะท้อนออกมากำมุม กับระบบของอนุภาคเท่ากับมุมของ ลำรังสีตกกระทบ [26] เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์ได้ ทั้งสารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง และนำมาใช้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกของสาร

ตัวอย่างได้อีกด้วย ทำให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ของสารประกอบต่าง ๆ กับรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ได้ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าในตัวอย่างนั้น ๆ มีสารประกอบอะไรอยู่บ้าง



รูปที่ 2.10 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffract Meter: XRD) [16]

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ของ XRD จะสามารถหาองค์ประกอบของตัวอย่างได้แล้วนั้น ยังสามารถคำนวณหาปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวอย่างคำนวณหาขนาดอนุภาคของแต่ละหน่วยเซลล์ ความเครียดของตัวอย่างค่าความเป็นผลึกของตัวอย่างได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของฟิล์มบาง และคำนวณค่าความหนาของชั้นฟิล์มบางได้อีกด้วย เครื่อง XRD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ในผลึกของตัวอย่าง โดยอาศัยหลักการของ Bragg's Law



รูปที่ 2.11 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ตาม Bragg's Law [17]

### 2.6.1.1 ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD

ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อหาปริมาณ หรือ ทางค์ประกอบตัวอย่างที่มีโครงสร้างอสันธฐาน (Amorphous) ได้ เนื่องจากสารตัวอย่างในกลุ่มนี้จะไม่เกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ แต่เราอาจจะสามารถให้ XRD คำนวนหาปริมาณของส่วนที่เป็นอสันธฐาน ในตัวอย่างว่ามีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ได้ โดยใช้การเปรียบเทียบกับปริมาณของสารมาตรฐานที่ทราบค่าแน่นอน

### 2.6.1.2 ลักษณะตัวอย่างที่เหมาะสมในการส่งเพื่อทดสอบ

เครื่อง XRD สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งในรูปแบบของแข็ง หรือ ตัวอย่างที่เป็นผง (Powder) ได้ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นของแข็ง ด้านที่ต้องการทดสอบผิวจะต้องเรียบ ส่วนในกรณีตัวอย่างที่เป็นผงจะต้องมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 325 เมช หรือ ประมาณ 40 ไมครอน (ผลกระทบคล้ายผงแป้ง) จึงจะให้ผลการทดสอบที่ดี โดยปริมาณที่ต้องใช้ในการทดสอบต่อครั้ง จะอยู่ ประมาณ 1 ถึง 2 กรัม ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นก้อน ต้องมีขนาดกว้างยาว ไม่เกิน 10 เซนติเมตร ทั้งนี้ พื้นที่ที่จะทำการทดสอบ จะเป็นเพียงบริเวณเล็ก ๆ ประมาณ 10 มิลลิเมตร เท่านั้น กรณีที่ตัวอย่าง มี ปริมาณน้อยมาก ๆ ก็อาจทำการทดสอบได้ โดยทางห้องปฏิบัติการจะใช้แผ่น Zero Background ใน การวางตัวอย่าง เพื่อทำการทดสอบต่อไป

## 2.6.2 เครื่องยูวี-วิส สเปกตรومิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) [18]

ยูวี-วิส สเปกตรومิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสง และค่าความเข้มข้นในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทางลูกผ่าน หรือ ถูกดูดกลืน โดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณ และชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะ เป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน และสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น



รูปที่ 2.12 เครื่อง ยูวี-วิส สเปกตรومิเตอร์ [19]

คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อไม่เลกูลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมจะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่า เมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่าน หรือ สะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่าง ๆ ตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนไม่เลกูลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้น จึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิด และปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้

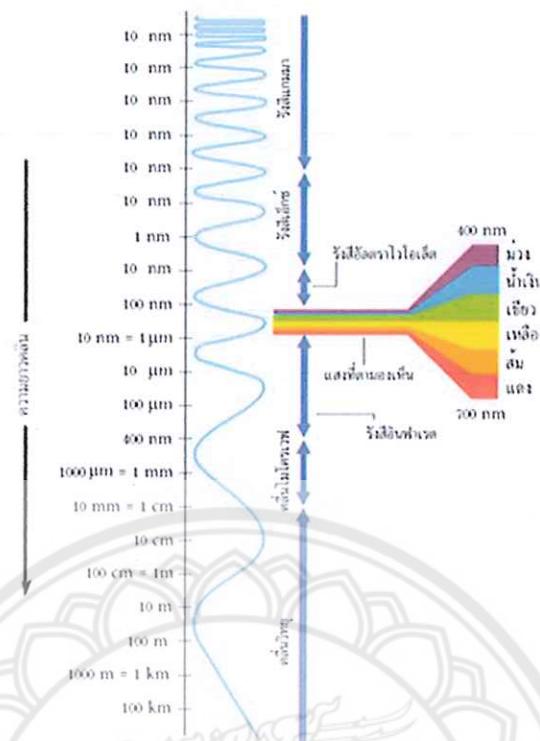
#### 2.6.2.1 ธรรมชาติของแสง [20]

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) แสงมีความเร็วในสัญญาณเท่ากับผลคูณของความยาวคลื่น และความถี่ แต่ความเร็วในการเดินทางจะเปลี่ยนไปเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางอื่น ๆ โดยมีความเร็วในการเดินทางเท่ากับ  $2.9979 \times 10^{-16}$  เซนติเมตรต่อวินาที ต่อ  $n$  ( $n$  = ตระชนีหักเหของตัวกลาง; Refractive Index) แสงต่างชนิดกันจะมีความยาวคลื่นต่างกัน และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแตกต่างกัน แสงแต่ละช่วงความยาวคลื่นถูกกำหนดให้มีชื่อเรียกต่างกันตามข้อกำหนดของ The Joint Committee On Nomenclature In Applied Spectroscopy ดังนี้

ก. แสงที่มองเห็น (Visible Light) เป็นแสงสีขาวที่เกิดจากการรวมกันของแสงสีต่าง ๆ มีสีหลักอยู่ 7 สี คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 400 ถึง 700 นาโนเมตร เมื่อแสงสีขาวตกกระทบวัตถุแล้วทำให้มองเห็นวัตถุเป็นสีได้แสดงว่าวัตถุดูดกลืนแสงสีอื่นหมดแต่สะท้อนแสงสีที่ตามองเห็นออกมาก แต่ถ้าวัตถุนั้น ๆ ดูดกลืนแสงทุกสีไว้ได้หมดจะมองเห็นวัตถุเป็นสีดำ

ข. แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Light) มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 210 ถึง 380 นาโนเมตร เป็นแสงที่มีคุณสมบัติในการทำให้อิเล็กตรอนของอะตอมเกิดการส่องผ่าน (Electronic Transmission) เมื่อร่างกายถูกแสงนี้เป็นเวลานานอาจเกิดอันตราย ตัวอย่างเช่น ผิวนังไม้เกรียม เยื่อบุคคลตាបุกทำลาย และอาจทำให้เกิดเป็นมะเร็งของผิวนังได้ เนื่องจากแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เอมีนเบส (Thymine Base) ในนิวเคลียสของเซลล์รวมตัวกัน

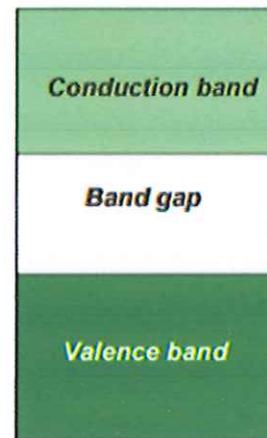
ค. แสงอินฟราเรด (Infrared Light) เป็นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถทำให้ไม่เลกูลของวัตถุต่าง ๆ เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนเกิดความร้อนขึ้นมาก เนื่องจากวัตถุส่วนใหญ่ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วง 3,000 ถึง 100,000 นาโนเมตร ได้ดี ดังนั้น จึงนิยมใช้รังสีอินฟราเรดในการทำให้วัตถุต่าง ๆ แห้ง เพราะ มีประสิทธิภาพในการทำให้แห้งสูงกว่าการใช้ความร้อนแบบธรรมดา



รูปที่ 2.13 UV-VIS สเปกตรัม [20]

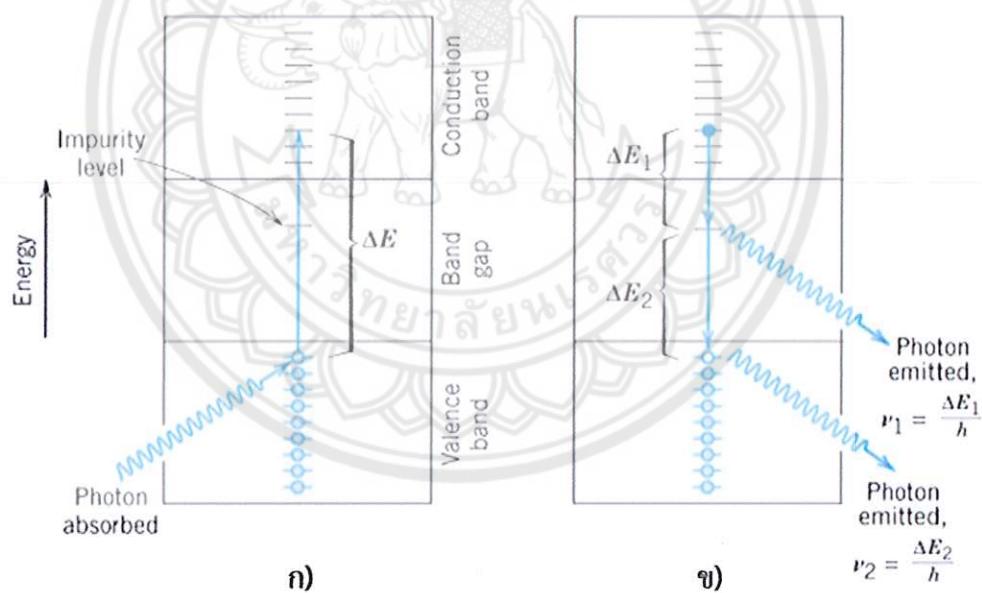
#### 2.6.2.2 การดูดกลืนแสงในวัสดุสารกึ่งตัวนำ [21 และ 22]

การดูดกลืนแสงในวัสดุสารกึ่งตัวนำเนื่องจากแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใส่สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กให้กับวัสดุ จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพาหะ และสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุนั้น ๆ ในวัสดุสารกึ่งตัวนำนั้นมีแบบช่องว่างพลังงาน (Band Gap) อยู่ค่าหนึ่ง และภายในช่องว่างพลังงานจะมีระดับพลังงานของสารเจือปน (Impurity Level) หรือจุดบกพร่อง ต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นพวกรถสถานะพลังงานเฉพาะ (Localized State) ถ้าเราวิเคราะห์สเปกตรัมของการดูดกลืน การสะท้อน หรือการเปล่งแสง จากวัสดุสารกึ่งตัวนำจะสามารถทราบค่าระดับพลังงานของสถานะพลังงานเฉพาะ และจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบช่องว่างพลังงาน ทั้งนี้ เพราะการดูดกลืนแสง การเปล่งแสงเกิดจาก การที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในแบบชั้นพลังงานใด ๆ หรือที่อยู่สถานะพลังงานเฉพาะ ดูดกลืนแล้วคายแสงออกมาระบุการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน ซึ่งค่าความแตกต่างของชั้นระดับ พลังงานที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเท่ากับพลังงานที่อิเล็กตรอนดูดกลืน หรือคายออกมานะ ความยาวคลื่นของแสงที่จะทำให้เกิดการดูดกลืนแสงตัวย่ออิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นในของอะตอม ได้แก่ ช่วงรังสีเอ็กซ์ อิเล็กตรอนในวัสดุกึ่งตัวนำ และ อนวน ที่จะสามารถเปลี่ยนชั้นพลังงานไปอยู่ใน Excited State ได้นั้นจะต้องมีพลังงานมากกว่า Energy Gap เสียก่อน



รูปที่ 2.14 ขั้นพลังงานของวัสดุกึ่งตัวนำ [22]

กรณีที่มีสารเจือ หรือ สารแบลกบลอม จะทำให้เกิดขั้นพลังงานพิเศษ ขึ้นมาในบริเวณช่องว่างของແບບพลังงาน (Band Gap) และ อาจมีการกระตุ้นหรือปล่อยพลังงาน (Excitation or Emission) หนึ่ง หรือ สองครั้ง



รูปที่ 2.15 การกระตุ้น และการปล่อยพลังงาน [22]

ก) การกระตุ้นพลังงาน

ข) การปล่อยพลังงาน

นำกฏของแพลนค์ (Planck's Law) หาเป็นกฏที่ใช้อธิบายสเปกตรัมการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทุกความยาวคลื่นจากวัตถุดำ (Blackbody) ที่อุณหภูมิ (Temperature) หนึ่ง ๆ กฏนี้คันพบโดย มัคซ์ พลังค์ (นักพิสิกส์ชาวเยอรมัน) และ เมื่อนำมาพัฒนา เป็นกราฟความสัมพันธ์ สมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง ( $\alpha$ ) และค่าพลังงานกระตุ้น (eV) ดังสูตรของกฏของแพลนค์

$$E = h\nu = hc / \lambda \quad (2.4)$$

เมื่อ	$E$	คือ	พลังงานของโฟตอน หน่วย จูล (J)
$h$	คือ	ค่าคงที่ของแพลนค์ $6.6 \times 10^{-34}$ จูล.วินาที (J.s)	
$\nu$	คือ	ความถี่ หน่วย เอิร์ทซ์ หรือ วินาที $^{-1}$ (Hz หรือ $s^{-1}$ )	
$c$	คือ	ความเร็วแสง $2.997 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที ( $m s^{-1}$ )	
$\lambda$	คือ	ความยาวคลื่นแสง หน่วย นาโนเมตร (nm)	

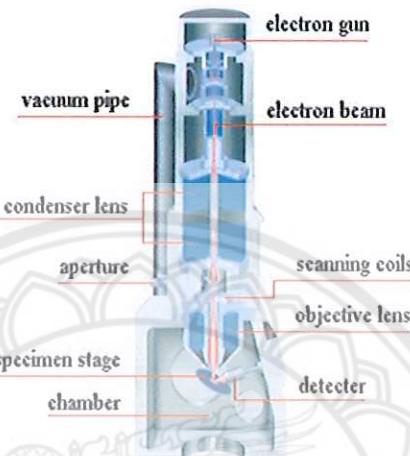
### 2.6.2.3 ทฤษฎีแบบพลังงาน [23]

คุณสมบัติการนำไฟฟ้าของผลึกสถานะของแข็งอาจพิจารณาได้จากแบบจำลองระดับพลังงาน เรียกว่า ทฤษฎีแบบพลังงาน โดยแบ่งแบบพลังงานเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นแบบพลังงานต่ำ เรียกว่า แอบ华าเลนซ์ (Valance Band) อิเล็กตรอนที่อยู่ภายในแบบพลังงานนี้คือ อิเล็กตรอนยึดเหนี่ยว ซึ่งถูกยึด ไว้โดยอะตอมใด ๆ ดังนั้นอิเล็กตรอน ณ แบบพลังงานนี้จะมีพลังงานศักย์ยึดเหนี่ยวสูงแต่มีพลังงานจลน์ น้อยถัดจากแอบ华าเลนซ์ คือ แบบซ่องว่างพลังงาน (Energy Gap Band) ซ่องว่างนี้คือ ที่ว่างระหว่างแอบ华าเลนซ์กับภายนอกอะตอม เนื่องจาก อิเล็กตรอนว่างวนรอบอะตอมเป็นวงโคจร และ อิเล็กตรอนต้องอยู่ ณ วงโคจรใด ๆ ดังนั้นอิเล็กตรอนใด ๆ จึงไม่สามารถเข้ามาอยู่ภายในแบบซ่องว่างพลังงานได้ แบบพลังงานช่วงที่ 3 เป็นแบบพลังงานสูง เรียกว่า แบบนำกระแส (Conduction Band) อิเล็กตรอนที่อยู่ ณ แบบพลังงานนี้เป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานมากพอที่จะหลุดออกจาก การยึดเหนี่ยวของอะตอม และ กลไกเป็นอิเล็กตรอนอิสระดังนั้น อิเล็กตรอน ณ แบบพลังงานนี้จะมีพลังงานศักย์ยึดเหนี่ยวต่ำมาก และ มีพลังงานจลน์สูงกระตุ้นด้วยพลังงานอีกเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า ได้แบบพลังงานของอนุวัน สารกึ่งตัวนำและตัวนำ

### 2.6.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนเป็นแหล่งกำเนิดแสง เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุในระดับจุลภาค เนื่องจากมีความยาวคลื่นสั้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานของวัสดุ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราดมีกำลังขยายมากกว่า 3000 เท่า จนถึงระดับมากกว่า 100000 เท่า และสามารถแยกแยะรายละเอียดของภาพ ซึ่งขึ้นกับลักษณะตัวอย่างได้ตั้งแต่ 3 ถึง 100 นาโนเมตร อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่น เช่น Energy Dispersive Spectrometry (EDS) และ Wavelength Dispersive Spectrometry (WDS) ที่เป็นข้อมูลทางเคมี



รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [24]

#### 2.6.3.1 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [24]

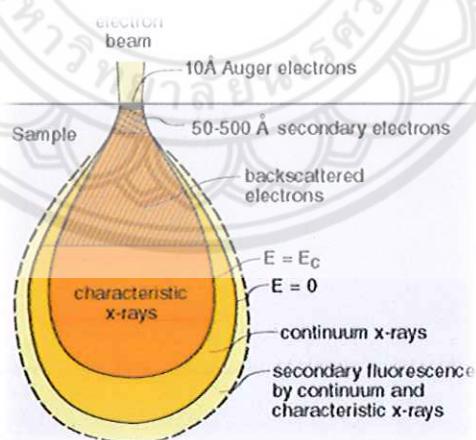
จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนเพื่อป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวมรังสี (Condenser Lens) เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนกลายเป็นลำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของลำอิเล็กตรอนใหญ่ หรือเล็กได้ตามต้องการ หากต้องการภาพที่มีความคมชัดจะปรับให้ลำอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นลำอิเล็กตรอนจะถูกปรับระยะไฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective Lens) ลงเป็นผิวชิ้นงานที่ต้องการศึกษา หลังจากลำอิเล็กตรอนถูกกราดลงบนชิ้นงานจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron) ซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ และถูกนำไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไป และสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ได้เลย ซึ่งลำอิเล็กตรอนที่วิ่งมากระแทบที่ชิ้นงานมีพลังงานสูง ทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากชิ้นงานมีหลายระดับพลังงาน แบ่งได้เป็น ดังรูปที่ 2.17

ก. อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron) เป็นอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากชิ้นแบบการนำ (Conduction Band) หรือ แบบพลังงานเวลาน์ (Valence Band) ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานสูงสามารถหลุดออกจากผิวชิ้นงานได้ง่าย บางครั้ง เรียกว่า อิเล็กตรอนอิสระ อิเล็กตรอน

ชนิดนี้จะใช้ในการสร้างภาพที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู (SEM)

ข. อิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ (Back Scattered Electron) เป็นอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่ลำอิเล็กตรอนปัตตันภูมิวิ่งเข้าชนกับชิ้นงาน แล้วทำให้สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในชิ้นงานบางส่วน แล้วเกิดการกระเจิงกลับออกมายกจากชิ้นงาน ซึ่งพลังงานของอิเล็กตรอนชนิดนี้จะมีค่าตั้งแต่พลังงานของอิเล็กตรอนปัตตันภูมิไปจนถึง พลังงานอิเล็กตรอนทุติยภูมิ ค่าพลังงานต่าง ๆ ที่กระเจิงกลับมานั้นจะขึ้นกับเลขมวลอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชิ้นงาน ดังนั้น อิเล็กตรอนชนิดนี้จึงสามารถใช้สร้างภาพที่แสดงความแตกต่างของธาตุได้ โดยแสดงในรูปแบบของความเข้ม และความสว่างของภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชิ้นงาน

ค. รังสีเอกซ์ (X-ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้น มีความถี่สูง เกิดจากการที่ลำอิเล็กตรอนพลังงานสูงวิ่งเข้าชนชิ้นงาน ทำให้อิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ ได้รับพลังงานมากพอนอกจากวงโคจร แล้วอิเล็กตรอนจากชั้นโคจรถัดไปเข้ามาแทนที่ทำให้มีการปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมายังสเปกตรัมของรังสีเอกซ์ที่ปล่อยออกมานี้สามารถนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยค่าพลังงานนี้จะขึ้นกับเลขอะตอมของธาตุ ซึ่งจะใช้หัวดูรังสีเอกซ์ (EDS) ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู (SEM)



รูปที่ 2.17 การทำงานร่วมกันของอิเล็กตรอน [24]

#### 2.6.3.2 ปริมาณตัวอย่างที่ต้องเตรียมเพื่อทำการวิเคราะห์

ปริมาณตัวอย่างที่ต้องเตรียมเพื่อทำการวิเคราะห์ หากเป็นแบบผง ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเป็นของแข็ง ควรเตรียมมาอย่างน้อย 2 ชิ้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรณีตัวอย่างเสียหาย โดยมีขนาดไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร (มีขนาดเล็กจะดีกว่า เนื่องจากตัวอย่างจะ

สามารถถ่ายอิเล็กตรอนลงกราวด์ได้ดีกว่า ป้องกันการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านจุดควบคุมตั้มเดี่ยวที่มีความสัมพันธ์) นอกจากนี้แล้วตัวอย่างทางชีวภาพที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ เช่น เนื้อเยื่อ ต้องทำการทำให้แห้งด้วย เอทานอล หรือ อะซิโตนมาก่อน และต้องมีขนาดไม่เกิน 5 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

## 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธ์ (2555) ได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์โดยวิธีโคล์พลาスマ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มบางของไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ และหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ฟิล์มด้วยเทคนิคโคล์พลาasma และเปรียบเทียบกับการสังเคราะห์ฟิล์มที่ไม่ได้ใช้เครื่องโคล์พลาasma โดยใช้วิธีการเผาแคลไชน์มีการสังเคราะห์ฟิล์มไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์ระหว่างสาร ละลายไฟฟ้าเนียมเตรคอลอเรต์กับน้ำกลั่นที่ความเข้มข้น 0.1 มอล บนแผ่นรองรับที่เป็นกระดาษภายใต้สภาวะของไนโตรเจนพลาสมาพร้อมกับให้อุณหภูมิตั้งแต่ 400 องศาเซลเซียส 450 องศาเซลเซียส 500 องศาเซลเซียส และ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ผลการทดลองพบว่า ฟิล์มที่เตรียมทั้งหมดในงานวิจัยนี้มีการตอบสนองต่อแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง 365 นาโนเมตรถึง 395 นาโนเมตร ซึ่งแสดงถึงการลดลงของช่องแอบพลังงาน ระหว่างแถบการนำ (Conduction Band) และ แถบเวลเอนซ์ (Valence Band) และมีค่าร้อยละการส่องผ่านแสงตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 80

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ (2555) ได้ทำการวิเคราะห์ไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน่สารรับการบัดก้าชมลพิษโดยกระบวนการโพโตคະตะไลซิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบัดมลพิษ อาจาด้วยปฏิกิริยาโพโตคະตะไลซิสโดยใช้ฟิล์มไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน่ที่ได้พัฒนาขึ้น ( โดยมีเป้าหมายคือได้ค่าจานวนพลาสติคสตอร์ของการย่อยสลายก้าชมลพิษชนิดต่าง ๆ ) การศึกษากระบวนการบัดก้าชมลพิษนั้นได้มีการทดสอบเบื้องต้นโดยมีการนำไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน่ที่สังเคราะห์ได้มาทำการทดลองบัดก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการโพโตคະตะไลซิส โดยใช้ดังปฏิกิริยาที่ใช้สัดต่างกัน คือ พลาสติกโลหะแก้วปีบโลหะและโลกรองมีแสงยูวีซี และแสงยูวีเอ เป็นแหล่งกำเนิดแสงพบว่าการบัดก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์โดยฉายแสงยูวีเอ และยูวีซีนั้นค่าความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าบอนมอนอกไซด์ คือ 1) ความร้อนภายในถังปฏิกิริยา เนื่องจากความร้อนจากหลอดไฟไปทำปฏิกิริยากับอุปกรณ์ต่าง ๆ 2) การเจือจางด้วยแอร์ซีโร (Air Zero) ที่มีส่วนผสมของก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำปฏิกิริยาในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแล้วสามารถถูกลายเป็นก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ ในด้านของประสิทธิภาพในการบัดนั้นเพิ่มผิวของไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน่ที่มากกว่าก็จะทำให้ประสิทธิภาพการบัดเพิ่มขึ้นแต่จะมีค่าต่างเมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนไฟฟ้าเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโน่ที่ใช้มีพื้นที่ผิวน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณของก้าชคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่ในถังปฏิกิริยา จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการบัดน้อย จากการทดลองที่ค่าความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนั้นได้ทำการควบคุมอุณหภูมิโดยการหล่อน้ำบริเวณ

ด้านล่างโถกรองและบริเวณรอบๆ โถกรองยกเว้นบริเวณที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาจะไม่มีน้ำไหลผ่านซึ่งส่งผลให้โถกรองมีอุณหภูมิเย็นลง และเปลี่ยนจากการเจือจากด้วยแอร์ซีโร่ (Air Zero) เป็นก้าซอ กซิเจน แทนพบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้น

โรสลินา ยูโซะ (2554) ได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะฟิล์มบางโดยใช้วิธีวัดทางแสงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเคลือบฟิล์มเชือโครเนียมโดยออกใช้น้ำด้วยวิธีสปัตเตอริง การทดลองในหัวข้อนี้ได้ทำการวิเคราะห์สมบัติทางแสงและความหนาของฟิล์มที่เตรียมด้วย วิธีแอกทีฟ แมgnีตรอนสปัตเตอริง โดยทำการเปลี่ยนแปลงเวลาในการเคลือบ 4 5 6 และ 7 ชั่วโมง ในการวิเคราะห์สมบัติทางแสงของฟิล์มได้ทำการเปรียบเทียบสมบัติทางแสงและความหนาของฟิล์มจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปิกอิลิปโซเมทรีและเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี อีกทั้งเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มด้วยภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกล้อง การวิเคราะห์สมบัติทางแสง และความหนาของฟิล์มเชือร์โโคเนียมโดยออกใช้น้ำด้วยไนคานิคส์สเปกโตรสโคปิกอิลิปโซเมทรี พบร่วมกับ แบบจำลองทางกายภาพสองชั้นและแบบจำลองทางแสงของคอร์ชีมีความเหมาะสม ในการวิเคราะห์ค่าดัชนีหักเหของฟิล์มในช่วงพลังงานไฟตอน 0.06 ถึง 3 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงรังสีอินฟราเรด และเมื่อทำการวิเคราะห์ค่าคงที่ทางแสงในช่วงพลังงานไฟตอน 0.06 ถึง 6 อิเล็กตรอนโวลต์ สามารถวิเคราะห์เพื่อหาค่าตัวแปรของสารกึ่งตัวนำได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งช่วงอัตราไฟโอเดตช่วงแสงที่ตามองเห็น และช่วงรังสีอินฟราเรด

### บทที่ 3

#### วิธีดำเนินโครงการ

##### 3.1 ขั้นตอน และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการทำโครงการ



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

### 3.2 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

#### 3.2.1 สารเคมี

- 3.2.1.1 ไทเทเนียมไออกไซด์ ( $Ti [OCH (CH_3)_2]_4$ )
- 3.2.1.2 ไดโพรพานอล
- 3.2.1.3 กรดน้ำส้ม ( $C_2H_4O_2$ )
- 3.2.1.4 เหล็กคลอไรด์ (III) ( $FeCl_3$ )
- 3.2.1.5 กรดไฮโดรคลอลิก

#### 3.2.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

##### 3.2.2.1 เตาเผา

##### 3.2.2.2 เครื่องขึงสาร

##### 3.2.2.3 เครื่องคนสารชนิดใช้สนามแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer)

##### 3.2.2.4 บีกเกอร์

##### 3.2.2.5 เครื่องจุ่มเคลือบสาร

##### 3.2.2.6 แม่เหล็กสำหรับคนสาร (Magnetic Bar Plain)

##### 3.2.2.7 กระบอกตวงสาร

##### 3.2.2.8 เครื่องทำความสะอาดผิวน้ำจาก (Ultrasonic Cleaner)

##### 3.2.2.9 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction)

##### 3.2.2.10 เครื่องวิเคราะห์ยูวี-วิสิเปิล สเปกโตรไฟโตนิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer)

##### 3.2.2.11 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy)

### 3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

#### 3.3.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูล

ศึกษาระบวนสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ วิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ว่ามีคุณสมบัติ ได้แก่ ด้านการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ด้านสมบัติทางแสง ด้านลักษณะสัมฐานวิทยา รวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 3.3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์

3.3.2.1 ใช้ไทเทเนียมไออกไซด์ 5.68 กรัม ไดโพรพานอล 84.32 มิลลิลิตร และกรดน้ำส้ม ปริมาณ 10 มิลลิลิตร โดยไม่ต้องเจือเหล็กคลอไรด์ (III) มาผสมกันในบีกเกอร์

3.3.2.2 คนสารละลายที่เตรียมไว้ให้เข้ากันด้วยแม่เหล็กสำหรับคนสาร (Magnetic Bar Plain) แล้วทำการเจือด้วยเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 เทียบกับกระจกที่ไม่ทำการเจือ ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ร้อยละสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ในไหเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณ 5.68 กรัม

สารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ในไหเทเนียมไดออกไซด์ (ร้อยละ)	เหล็กคลอไรด์ (III) (กรัม)
ไม่ได้ทำการเจือ	0
2	0.056
4	0.112
6	0.168
8	0.224
10	0.280

### 3.3.3 ขั้นตอนการจุ่มเคลือบสาร (Dip Coat)

- 3.3.3.1 นำกระ杰กสไลด์ ทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดผิวกระ杰ก (Ultrasonic Cleaner) เซ็ดให้แห้ง
- 3.3.3.2 แล้วทำการแพะเทปไปที่กระ杰กด้านใดด้านหนึ่ง
- 3.3.3.3 นำกระ杰กที่ได้มานะนีบกับที่เครื่องจุ่มเคลือบสาร
- 3.3.3.4 นำสารที่เตรียมไว้ไปวาง ณ ตำแหน่งที่จะทำการจุ่ม
- 3.3.3.5 ตั้งค่าความเร็วที่จะปล่อยกระ杰กที่ติดกับเครื่องให้ค่อย ๆ เลื่อนลงมาจุ่มในสารที่เตรียมไว้ โดยตั้งค่าที่ความเร็ว 10 มิลลิเมตร ต่อ นาที และเริ่มทำการจุ่มเคลือบ



รูปที่ 3.2 เครื่องจุ่มเคลือบ

3.3.3.6 เมื่อเครื่องทำการจุ่มสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารจากออกจากเครื่องจุ่ม เคลือบสารแล้วไปวางบนเครื่องคนสารชนิดใช้สนานมแม่เหล็ก ใหมด ความร้อน เพื่อให้กระจัดแห้ง



รูปที่ 3.3 เครื่องคนสารชนิดใช้สนานมแม่เหล็ก (Magnetic Stirrer)

3.3.3.7 ทำข้า ดังข้อ 3.3.3.4 3.3.3.5 ตามลำดับ เป็นจำนวน 7 รอบ

3.3.3.8 รอบที่ 7 เมื่อทำให้แห้งโดยวางบนเครื่องคนสารชนิดใช้สนานมแม่เหล็ก ใหมด ความร้อน จนกระจัดแห้งแล้วเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวในเตา

3.3.3.9 ทำข้าขันตอนข้างต้นทั้งหมดที่ปริมาณสารเจือร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 เทียบกับกระจากที่ไม่เจือ

#### 3.3.4 ขั้นตอนการศึกษาสมบัติพื้นฐานของไฟไทดีเจียมไดออกไซด์

3.3.4.1 เพสของไฟไทดีเจียมไดออกไซด์จะถูกศึกษาโดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

3.3.4.2 ความสามารถในการดักลึกลงแสงในย่างความถี่วิวีและย่างความถี่ที่ตามองเห็นได้ (300 ถึง 800 นาโนเมตร) ถูกวัดโดยเครื่อง ยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์

3.3.4.3 ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาที่พบโดยเครื่องอิเล็กทรอนแบบส่องกราด

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง และการวิเคราะห์

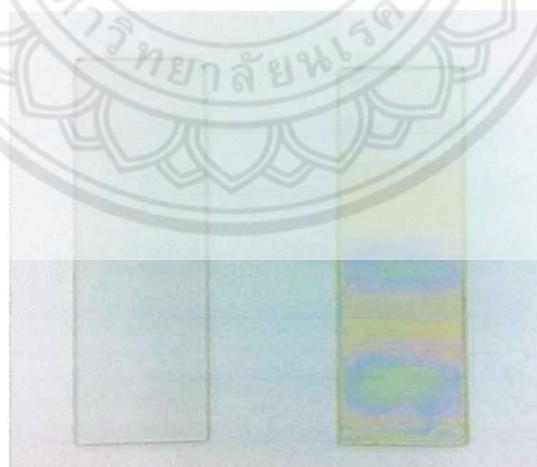
ในผลการทดลอง และการวิเคราะห์ นี้จะกล่าวถึงผลการศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มบางที่เจือด้วยเหล็กคลอร์ไอด์ (III) ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทำการเจือเหล็กที่ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 เทียบกับกระจักรที่ไม่ได้ทำการเจือโดยวิธีการจุ่มเคลือบจำนวน 7 ครั้ง และผลกระทบของสารเจือที่มีผลต่อฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซซ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านลักษณะสัณฐานวิทยา และสมบัติทางแสง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 4.1 ลักษณะกระจักรที่ทำการเจือ และไม่ได้ทำการเจือเทียบกับกระจักรธรรมชาติ

##### 4.1.1 ลักษณะพื้นผิว

จากการศึกษาระบวนการจุ่มเคลือบที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็นระบบนการหลักที่ใช้ในการเคลือบสารให้ติดบนกระจักร เมื่อทำการจุ่มเคลือบสารละลายที่การผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้ว ประกอบไปด้วยสารตั้งต้นไทเทเนียมไอโซโพโรกไซด์ ไดเพรพาโนล กรดน้ำส้ม และสารเจือเหล็กคลอร์ไอด์ (III) ที่เติมในสัดส่วนร้อยละ 2 4 6 8 และ 10

พบว่ามีสีของกระจักรที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับกระจักรธรรมชาติเห็นว่าฟิล์มที่เคลือบนกระจักรมีครบ ร่องรอยของสารที่เคลือบติดบนผิวกระจากรอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 4.1

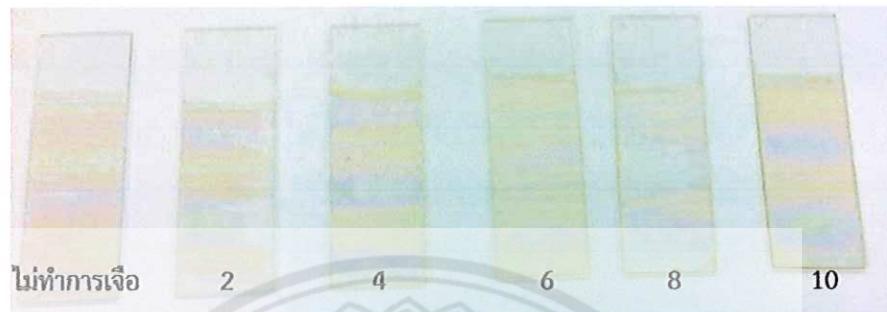


ก) ข)

รูปที่ 4.1 ลักษณะของกระจักรที่ทำการเคลือบ

- ก) กระจักรธรรมชาติ
- ข) กระจักรที่ผ่านการจุ่มเคลือบ

นอกจากนี้ในทุก ๆ สัดส่วนที่ทำการเจือเหล็กคลอไรด์(III)ที่เติมในสัดส่วนร้อยละ 2 4 6 8 10 และกระจายที่ไม่ได้ทำการเจือไอออนคลอไรด์ก็พบร่องรอยของสารเคลือบเช่นกัน พบว่าไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้นจึงไม่สามารถบอกความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีดูด้วยตาลักษณะทางกายภาพที่พบรห์ได้ ดังรูป 4.2

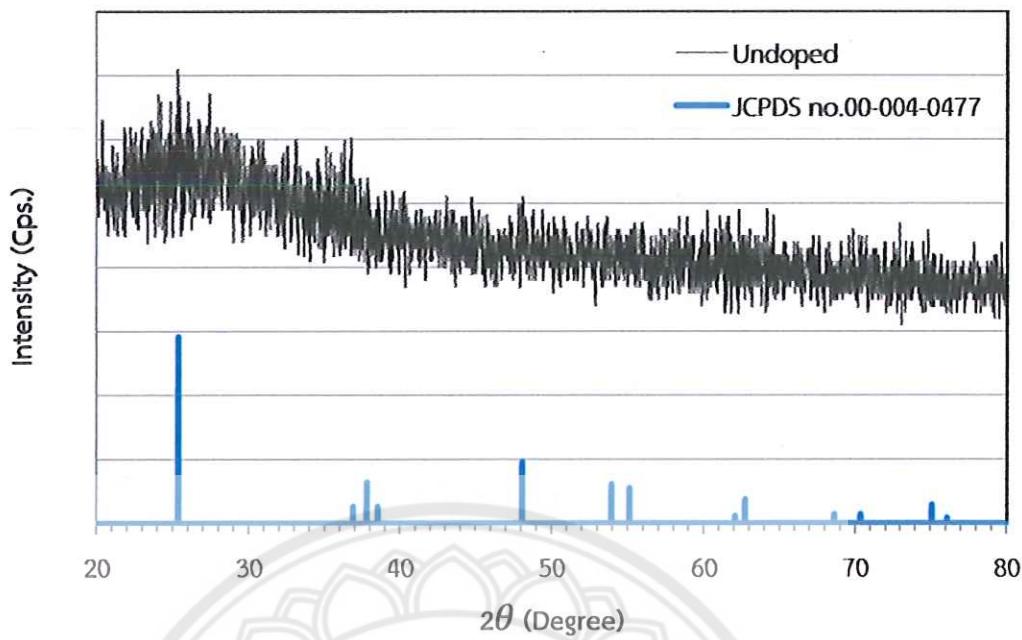


รูปที่ 4.2 ร้อยละของสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III)

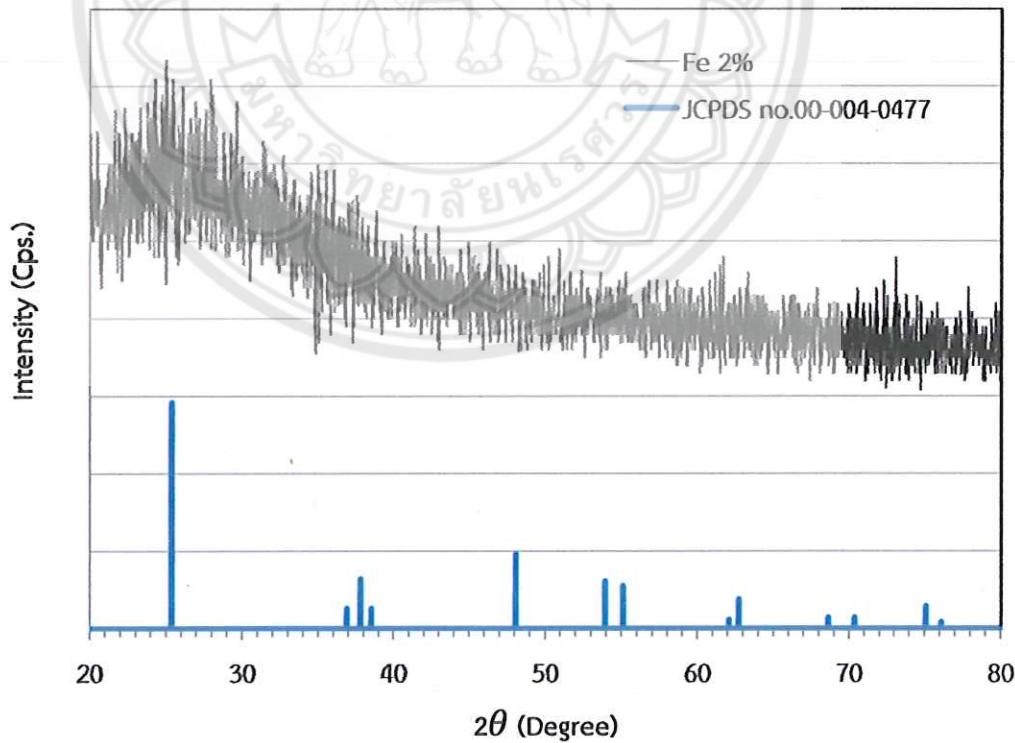
#### 4.2 ผลการวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD)

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไบทเนียมได้岀ออกไซด์ที่ทำการเจือเหล็กในสัดส่วนต่าง ๆ และที่ไม่ได้ทำการเจือ ซึ่งถูกศึกษาโดยใช้วิธีวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่วัดโดยเครื่อง (X-Ray Diffraction, XRD) ผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลมาตรฐาน JCPDS เพื่อระบุวัสดุภาคองค์ประกอบของสารตัวอย่างที่พบร พบว่าลักษณะของกราฟที่ได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ไม่ชัดเจน ทั้งฟิล์มที่ไม่ได้ทำการเจือเหล็กคลอไรด์ (III) และฟิล์มที่ทำการเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ปริมาณต่าง ๆ เนื่องจากฟิล์มที่ทำการเคลือบบนกระজันนั้นมีความบางมาก

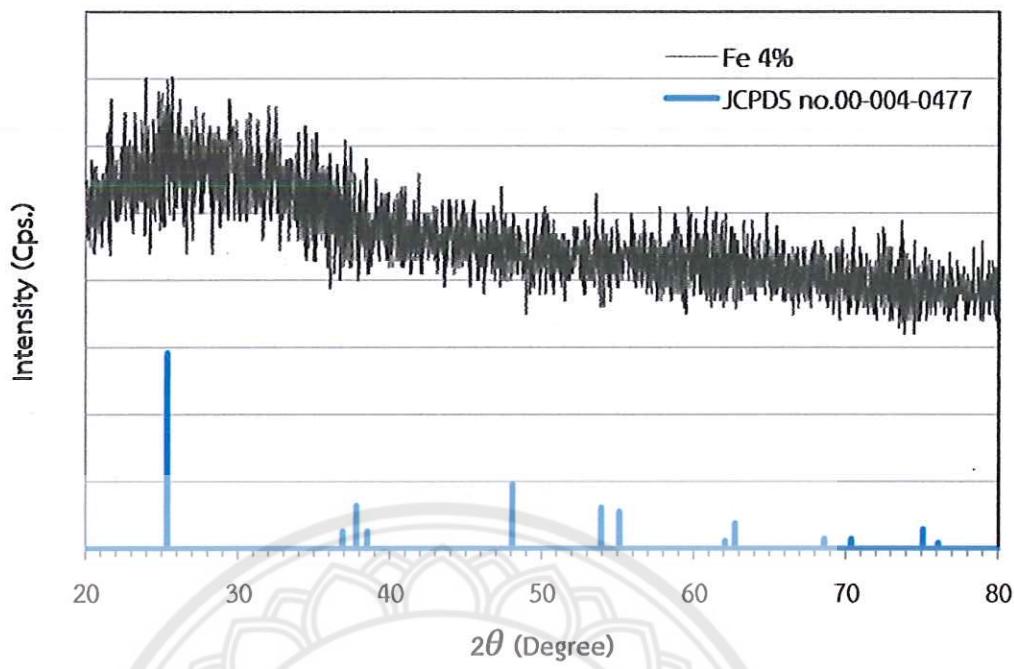
อย่างไรก็ตามกราฟสามารถบอกได้ว่าฟิล์มบางที่ได้รับเป็นสารประกอบไบทเนียมได้ออกไซด์โดยมีเฟสเป็นแบบอนาทาส เนื่องจากเมื่อนำกราฟที่ได้จากการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของฟิล์มบางไบทเนียมได้ออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ปริมาณต่าง ๆ ไปเทียบกับมาตรฐาน JCPDS ของไบทเนียมได้ออกไซด์ จะพบว่ามีชาตุไบทเนียมได้ออกไซด์ที่มีเฟสเป็นอนาทาส ในทุก ๆ ปริมาณของสารที่ทำการเจือ จะแสดงดังรูปที่ 4.3 ถึง รูปที่ 4.8 เมื่อเทียบกับมาตรฐาน JCPDS



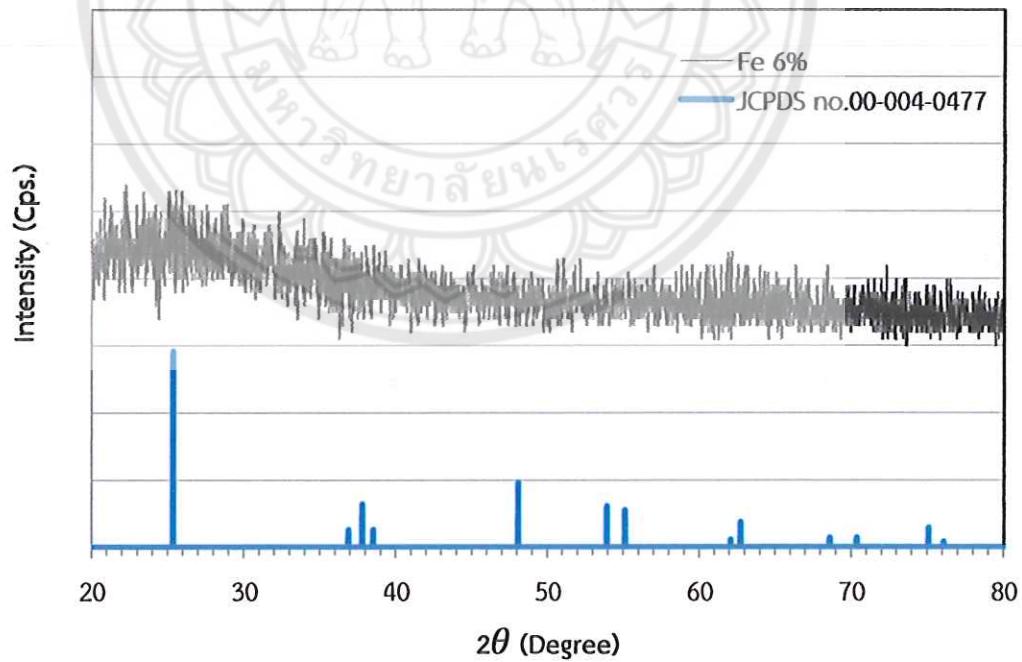
รูปที่ 4.3 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไบเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่ได้ทำการเจือเทียบกับ JCPDS ของไบเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อสอนหาส



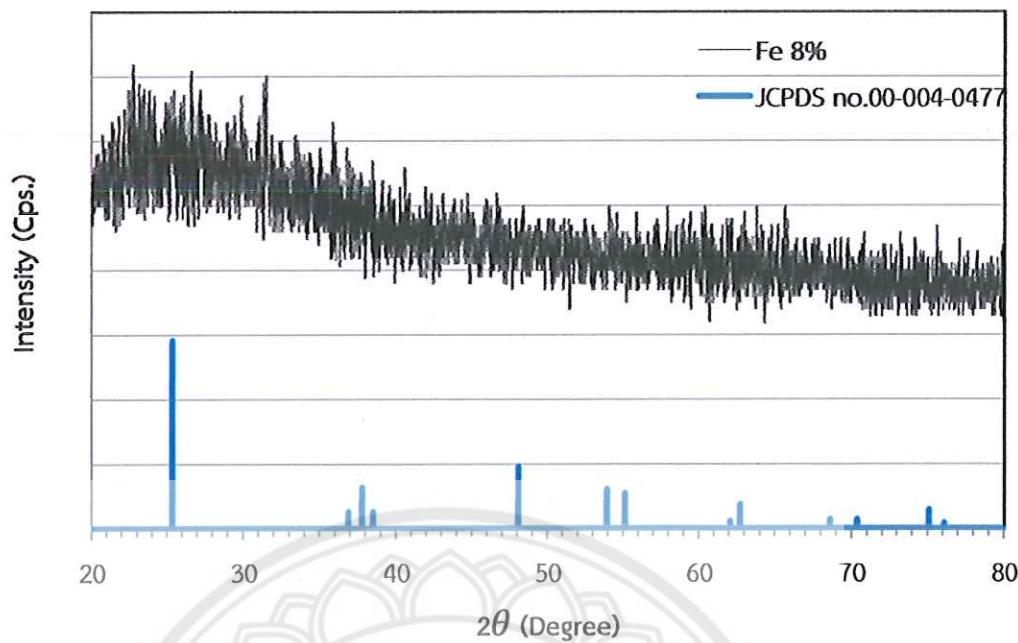
รูปที่ 4.4 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไบเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 2 เทียบกับ JCPDS ของไบเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อสอนหาส



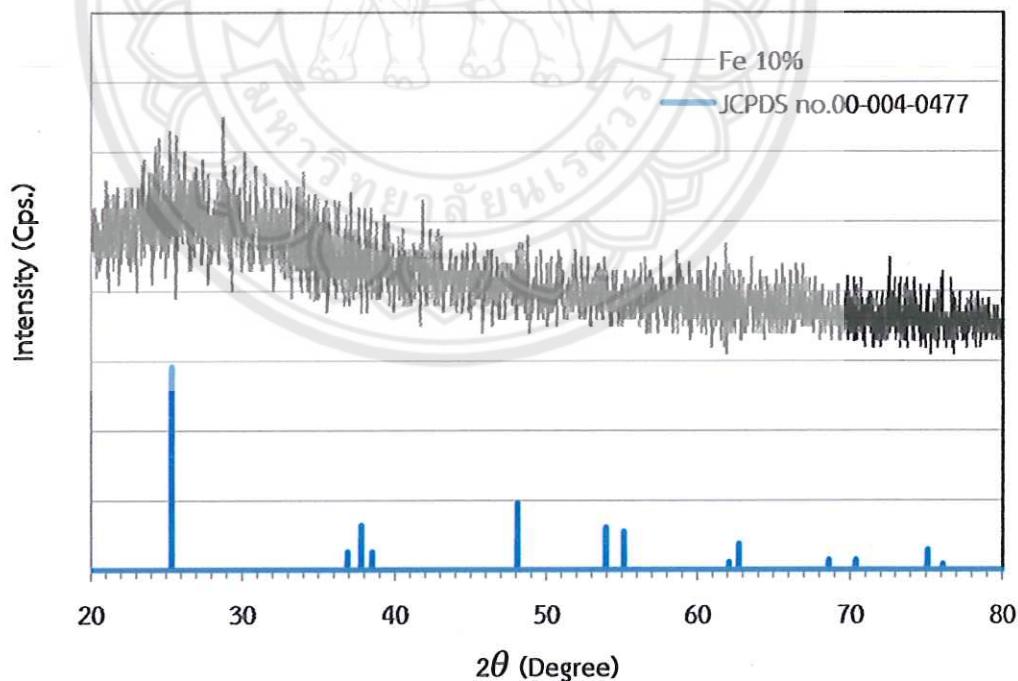
รูปที่ 4.5 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 4 เทียบกับ JCPDS ของไหเทเนียมไดออกไซด์ เฟสอนาคต



รูปที่ 4.6 กราฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 6 เทียบกับ JCPDS ของไหเทเนียมไดออกไซด์ เฟสอนาคต



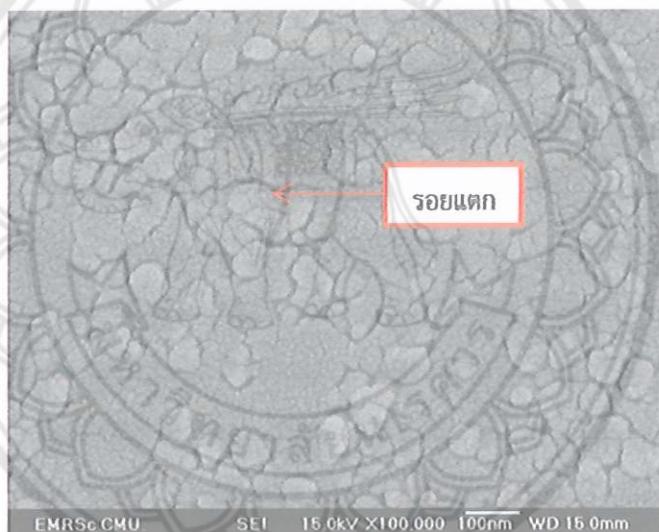
รูปที่ 4.7 グラฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 8 เทียบกับ JCPDS ของไหเทเนียมไดออกไซด์ เพ夫โซนาทาส



รูปที่ 4.8 グラฟการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ไหเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 10 เทียบกับ JCPDS ของไหเทเนียมไดออกไซด์ เพ夫โซนาทาส

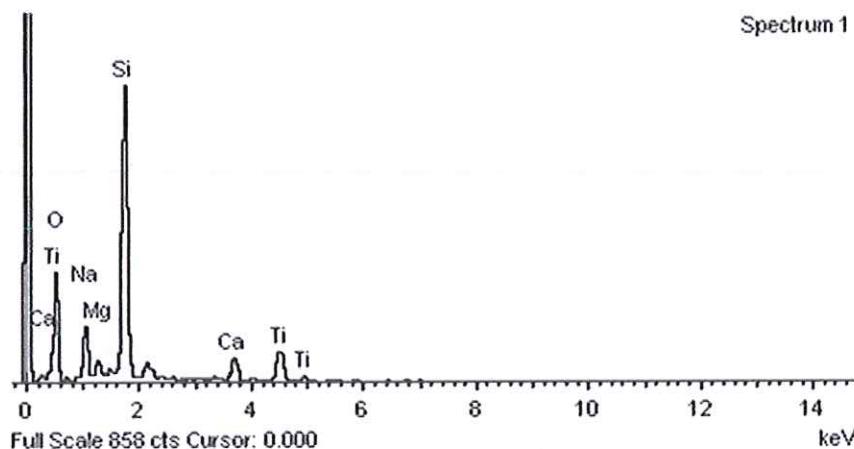
### 4.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy)

จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมได้岡กใช้ที่มีการเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ปริมาณต่าง ๆ คือ ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 ที่ทำการจุ่มเคลือบ 7 รอบ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส นำตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์จากเครื่อง SEM ที่กำลังขยาย 100,000 เท่า พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมที่ไม่ได้ทำการเจือเหล็กคลอไรด์ (III) จะมีรอยแตกเกิดขึ้น เพราะ การหดตัวของสารเคลือบในขณะที่ให้ความร้อนโดยฉับพลันทำให้ฟิล์มที่เคลือบบนกระজานน้ำเกิดรอยแตกขึ้นบนกระจะ [25] ดังรูปที่ 4.9 ก) และจากข้อมูล EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) ดังรูปที่ 4.9 ข) ซึ่งได้จากฟิล์มที่ไม่ได้ทำการเจือพบราดูที่คาดว่ามาจากการลอกเป็นชิ้นๆ ที่ทำการเคลือบลงบนกระจะ คือ ธาตุไทเทเนียม (Ti) ธาตุออกซิเจน (O) ด้วยข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบกับฟิล์มที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ร้อยละ 10



ก)

รูปที่ 4.9 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) ของกระจะที่ไม่ได้ทำการเจือ  
ก) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ไม่ได้ทำการเจือ



x)

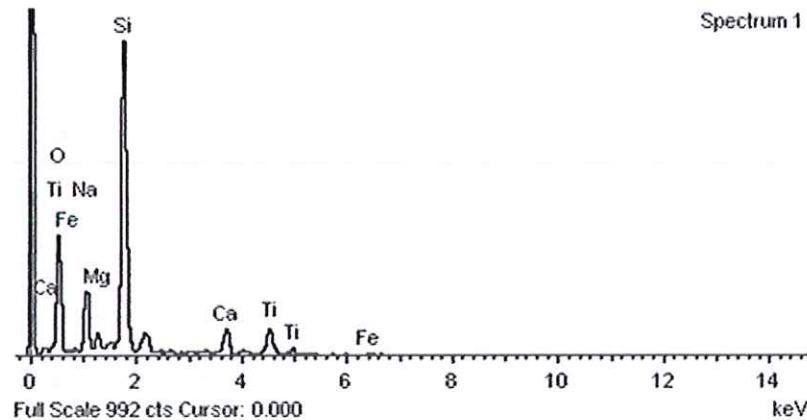
รูปที่ 4.9 (ต่อ) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) ของกระเจ้าที่ไม่ได้ทำการเจือ  
x) ผลจาก EDS ของกระเจ้าที่ไม่ได้ทำการเจือ

พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปเกมนีลักษณะเล็ก รอยแตกหายไป และพบจุดสว่างที่ขาวขึ้นบนภาพ ด้วยข้อมูลจาก EDS ปรากฏพบรารเจือเหล็ก ร้อยละ 0.74 โดยน้ำหนัก (ดังรูปที่ 4.10 ค) อย่างชัดเจนซึ่งด้วยสารที่ปราภูนี้เองทำให้เคราะห์ได้ว่า เหล็กที่ปราภูเป็นสารเจือเหล็กคลอร์ไรด์ (III) ซึ่งเป็นโลหะหนัก เนื่องจากเมื่อทำการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดจึงพบจุดสว่างที่ขาวขึ้นบนภาพ และมีผลทำให้ขนาดเล็กลงตามไปด้วย (ดังรูป 4.10 ก) ส่วนธาตุอื่น ๆ ที่พบ เช่น ธาตุโซเดียม (Na) ธาตุแมกนีเซียม (Mg) ซิลิกอน (Si) ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่บนกระดาษสไลด์เนื่องมาจากกระบวนการจุ่มเคลือบสนับสนุนจากข้อมูล EDS (ดังรูป ข)



g)

รูปที่ 4.10 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) ของกระเจ้าที่ทำการเจือร้อยละ 10  
g) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ทำการเจือร้อยละ 10



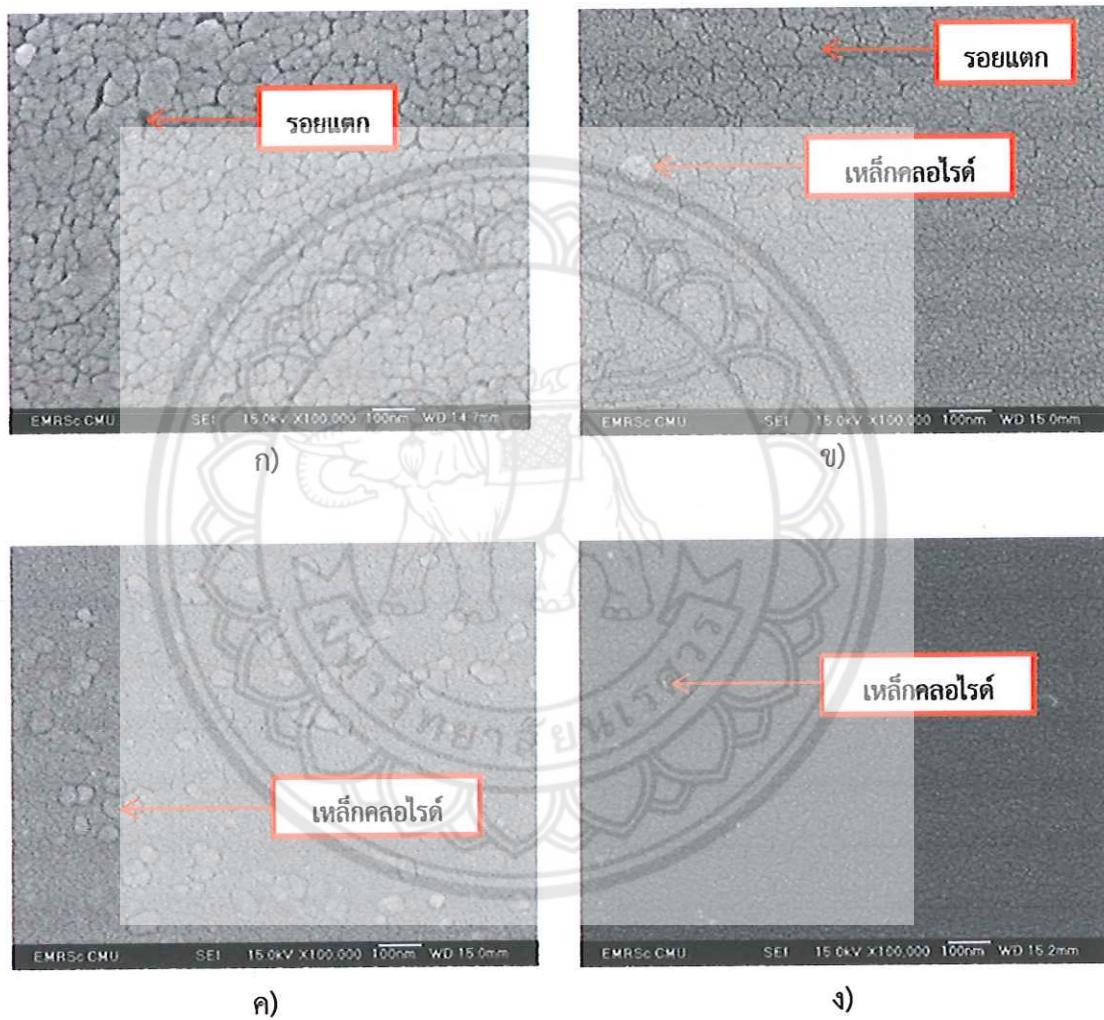
ก)

Element	Weight%	Atomic%
O K	42.09	57.64
Na K	7.97	7.59
Mg K	1.81	1.64
Si K	33.10	25.82
Ca K	5.50	3.01
Ti K	8.78	4.02
Fe K	0.74	0.29
Totals	100.00	

ค)

- รูปที่ 4.10 (ต่อ) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และผลจาก EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) ของกระจกที่ทำการเจือร้อยละ 10
- ข) ผลจาก EDS ของกระจกที่ไม่ได้ทำการเจือ
  - ค) ปริมาณของเหล็กพบร้อยละ 0.74

ส่วนที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ทั้งร้อยละ 2 4 6 8 พิล์มจะมีรอยแทกลดลงเรื่อยๆ จนไม่เห็นรอยแทก เป็นผลมาจากการปริมาณของสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่เพิ่มลงไปลงไประดับเข้าไปแทนที่ เข้มระหว่างรอยแทกของพิล์ม นอกจากนี้เกรนจะมีลักษณะเปลี่ยนไป และเล็กลงเช่นกันเป็นผลกระทบจากปริมาณเหล็กคลอไรด์เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเหล็กคลอไรด์ (III) เข้าไปแทนที่เกรนเล็กลง เพราะ เป็นไปตามทฤษฎีเมื่อเหล็กคลอไรด์ (III) เข้าไปไปขัดขวางการโตของไฟฟานียมไดออกไซด์ไป เยี่ยงกันโดยเกรนจึงเล็กลง [25] สามารถเห็นได้จากรูปที่ 4.11

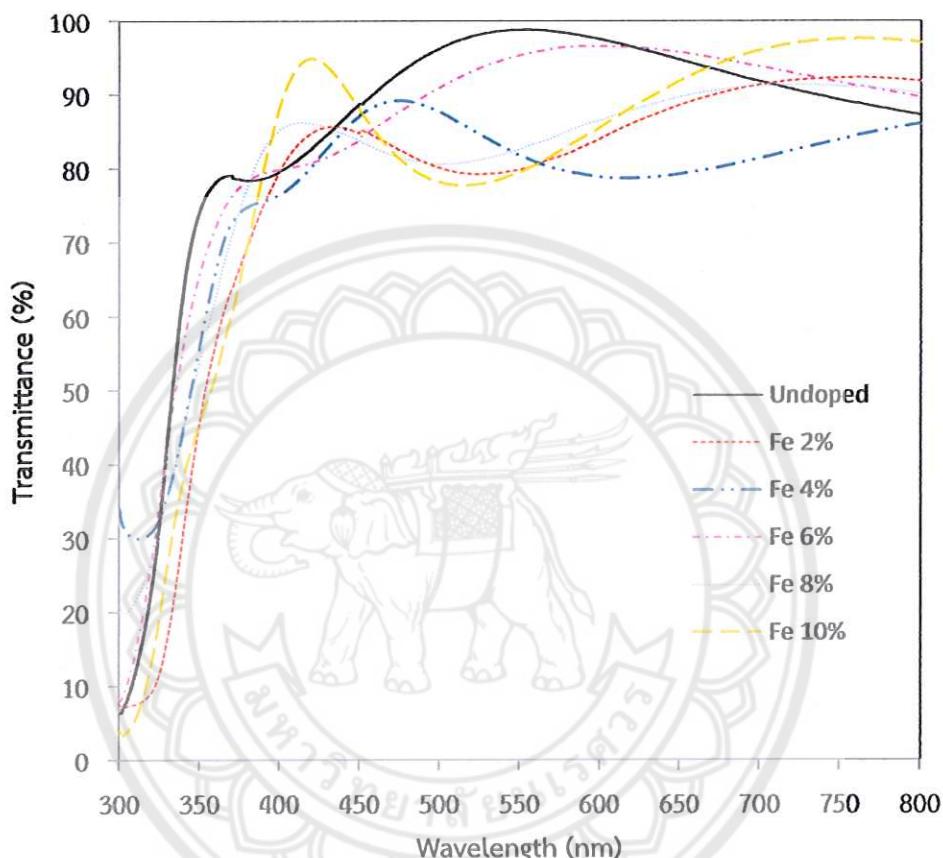


รูปที่ 4.11 ภาพกระชากที่ทำการเคลือบแล้วจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

- ก) พิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 2
- ข) พิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 4
- ค) พิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 6
- ง) พิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่เจือเหล็กคลอไรด์ (III) ร้อยละ 8

#### 4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางแสงจากเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer

ค่าการส่องผ่านของแสงของฟิล์มบางเป็นสมบัติทางแสงที่มีความจำเป็นในการศึกษาโดยได้ทำการวัดค่าการส่องผ่านของแสงอันเนื่องมาจากการบริบูรณ์สารที่เจือออกไซด์ในฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์

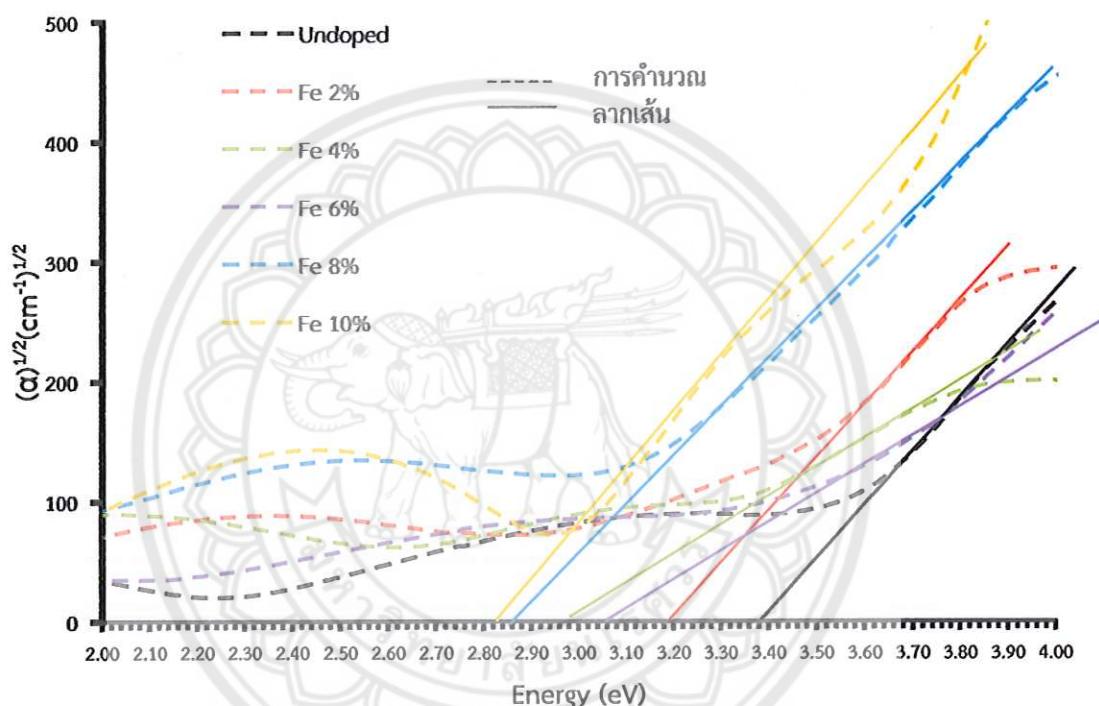


รูปที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น กับ เปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านของแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์

ดังรูปที่ 4.12 แสดงความยาวคลื่นของการทะลุผ่านของแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 ถึง 800 นาโนเมตรผ่านฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กคลอไรด์ (III) ในปริมาณต่าง ๆ พบว่า เส้นกราฟที่มีการเจือด้วยเหล็กคลอไรด์ (III) มีแนวโน้มของร้อยละการส่องผ่านที่ลดลง และยังพบว่าสามารถวิเคราะห์ความยาวคลื่นที่ 400 นาโนเมตรของฟิล์มบางกราฟเริ่มแนวโน้มที่ตกลง โดยฟิล์มบางที่ทำการเจือมีร้อยละ การส่องผ่านแสงสามารถส่องผ่านแสงได้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับกระเจรษธรรมดามีค่าสูงกว่า นอกจากนี้พบว่าในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 บวกได้ถึง ความหนาของฟิล์มที่ได้ทำการจุ่มเคลือบ เนื่องจากกราฟที่ได้ปรากฏค่าสูงต่ำสลับกันไปมาตามการแทรกสอดของแสง แสงบางส่วนจะสะท้อนที่รอยต่อของอากาศกับผิวฟิล์ม และแสงบางส่วนจะผ่านเข้าไปในเนื้อฟิล์มแล้วสะท้อนที่รอยต่อของผิวฟิล์มกับอากาศอีกด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตามแสงที่กระทบ

เข้าไปที่ผิวฟิล์มแล้วเกิดการสะท้อนล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดที่ความถี่เท่ากัน เมื่อเกิดการแทรกสอดแล้วเกิดการซ่อนทับของคลื่นจะเกิดการรวมกันแบบเสริม เรียกว่า จุดปฏิบัพ (Antinode) และ จุดบัพ (Node) จะเป็นตำแหน่งที่คลื่นหักล้างกันจนหมดราบเงยมีลักษณะเป็นรูปไข่ นอกจากปรากฏการแทรกสอดยังบ่งบอกได้ถึงความเรียบของผิวที่เกิดขึ้น

จากข้อมูลค่าการส่องผ่านของแสง รูปที่ 4.12 สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณแล้วมาหา พอตกราฟความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดคลื่นแสง ( $\alpha$ ) และค่าพลังงานกระตุ้น (eV) ของฟิล์ม บางไทเทเนียมได้ออกไซด์ได้ ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานโฟตอน (Photonenergy) กับ ค่าการดูดคลื่นของฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์

พบว่าสารเจือเหล็กคลอร์ไรด์ (III) ในฟิล์มบางไทเทเนียมได้ออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ มีผลต่อค่าพลังงานแคบช่องว่างดูจากเส้นทึบ ดังแสดงในรูปที่ 4.11 จะสังเกตเห็นได้ว่า ฟิล์มบางไทเทเนียม-ได้ออกไซด์ที่ไม่ได้ทำการเจือนั้นมีค่าพลังงานกระตุ้นมีค่าเท่ากับ ดังตารางที่ 4.1 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าปริมาณของสารเจือ กับ ค่าແນບช่องว่าง (Band Gap) ในการทดลอง

สารเจือเหล็กคลอร์ด (III) ในไทเทเนียมไดออกไซด์ (ร้อยละ)	ค่าແນບช่องว่าง (Band gap) (eV)
ไม่ทำการเจือ	3.38
2	3.20
4	2.98
6	3.06
8	2.86
10	2.82

จากค่าที่ในตารางที่ 4.1 ทำให้ทราบว่าเมื่อทำการเจือด้วยเหล็กเหล็กคลอร์ด(III)มากขึ้นส่งผลให้ ແນບช่องว่างมีค่าลดลงกว่ากระจกที่ไม่ได้ทำการเจือ แสดงว่าพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนจาก วาเลนซ์แบนด์ (Valence Band) ขึ้นไปบนคอนดักชันแบนด์ (Conduction Band) ใช้พลังงานที่น้อยลง เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย



## บทที่ 5

### บทสรุป และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของผลการทดลองการสังเคราะห์ฟิล์มบางไฟเทเนียมโดยออกไซด์ผลกระทบของปริมาณสารเจือที่มีผลต่อสมบัติทางโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และสมบัติทางแสงที่เกิดขึ้น ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนา และการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ของงานวิจัย โดยมีลักษณะดังนี้

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

ในการสังเคราะห์ฟิล์มบางไฟเทเนียมโดยออกไซด์โดยวิธีการจุ่มเคลือบในปริมาณสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 ซึ่งสรุประยะละเอียดได้ดังนี้

5.1.1.1 จากการสังเคราะห์ฟิล์มบางไฟเทเนียมโดยออกไซด์โดยวิธีการจุ่มเคลือบนี้ ไม่ว่าจะทำการเจือที่ปริมาณสารเจือที่เท่าใด กระบวนการนี้สามารถพบว่าสารที่ใช้เคลือบกระจากสารตั้งต้นไฟเทเนียมໄโอลิฟ์ฟอฟออกไซด์ จุ่มติดที่ผิวกระจากจริง เนื่องจากหลังการจุ่มมีร่องรอยของสารเคลือบติดอยู่ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 4.1

นอกจากลักษณะของกระจากที่ทำการเคลือบ ดังรูปที่ 4.1 ที่จะบอกได้ว่าฟิล์มติดที่ผิวของกระจากแล้ว การทดลองนี้ได้นำกระจากไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction) ซึ่งเทียบได้กับนำรูปมาตรฐาน JCPDS no. 00-004-0477 มาอ้างอิงทำการเทียบ กันแล้วมีพิเศษที่ตรงกัน พบว่ากระจากมีรูตุไฟเทเนียมโดยออกไซด์ที่เป็นเฟสอนาทาสอยู่

5.1.1.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาทำการวิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ที่กำลังขยาย 100000 เท่า จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางที่ทำการเจือด้วยสารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ที่ปริมาณต่างกัน พบว่า ที่ปริมาณสารเจือยิ่งเพิ่มมากขึ้นทำให้ที่ผิวของฟิล์มน้ำกระจากไม่เกิดรอยแตก มีความเรียบขึ้นของผิวเมื่อเทียบกับกระจากที่ไม่ได้ทำการเจือสารแล้ว และเมื่อทำการเจือไปที่ร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 พบว่าที่ทำการเจือที่ร้อยละ 10 เหมาะสมหากจะถูกนำมาใช้งานด้วยเหตุนี้ปริมาณสารเจือที่ใส่นั้นส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

5.1.1.3 สมบัติทางแสงจากผลการวิเคราะห์ พบรค่าแอบซองว่าง (Band Gap) มีค่าที่ลดลงผลกระทบเกิดจากปริมาณสารเจือยิ่งปริมาณสารเจือนาก ส่งผลให้มีการดูดกลืนแสงมากขึ้นแต่ในทางกลับกันค่าการส่องผ่านแสงจะมีค่าลดลง

## 5.2 ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

5.2.1 น้ำที่ใช้ในการล้างบีกเกอร์ก่อนนำมาใช้งานไม่ควรใช้น้ำธรรมชาติ ให้ใช้น้ำดีไอ (Deionized water) เป็นน้ำที่ผ่านการกำจัดไอออนต่าง ๆ ออกไปหมดแล้วมีบริสุทธิ์สูง เนื่องจากน้ำธรรมดามีสิ่งเจือปนมากกว่าน้ำดีไอ

5.2.2 ก่อนผสมสารทุกครั้งควรผสมไหเทเนียมไอโซโพกไซด์ กับ ไดโพรพานอลก่อน เพราะถ้าใส่ไหเทเนียมไอโซโพกไซด์ กับ กรดน้ำส้มก่อน เพราะจะทำให้สารเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนทำให้สารละลายที่ได้มีความชุ่นและทำให้ผลการทดลองเกิดการผิดพลาดขึ้น

5.2.3 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทุกครั้งจะต้องทำความสะอาดบีกเกอร์ที่ใช้แล้ว ไม่ควรใช้น้ำเปล่าธรรมชาติเด็ดขาด ควรล้างด้วยกรดไฮโดรคลอริกก่อนแล้วถึงจะล้างด้วยน้ำธรรมชาติได้ หากล้างด้วยน้ำธรรมดามีสารอยู่ในบีกเกอร์ น้ำจะทำปฏิกิริยากับสารในเหลือในบีกเกอร์ จับตัวเป็นของแข็ง “ไปติดตามภาชนะ” หรือ ตันที่ห่อทิ้งสารได้

5.2.4 ในการจัดเก็บตัวอย่างขึ้นงานไม่ควรจะใช้กระดาษทิชชูห่อขึ้นงานรวมกัน แต่ควรจะทำซองเก็บขึ้นงานเป็นล็อก ๆ ไม่เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสี และการหลุดออกของฟิล์มบางที่เคลือบ

## 5.3 ข้อเสนอแนะ และการพัฒนา

5.3.1 ในการทำการทดลองขั้นตอนให้ฟิล์มบางแห้งโดยวางบนเครื่องคนสารชนิดใช้ spanning แม่เหล็ก ควรจะใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเกิน 100 องศาเซลเซียส เพื่อฟิล์มบางจะได้ไม่เกิดการหดตัว ขณะรอให้แห้งมากจนเกินไป

5.3.2 ในการทำการอบก่อนทำการอบขั้นงานควรลอกสติกเกอร์ใส่ออกก่อน และทำความสะอาดโดยการเช็ดคราบกาวออกให้หมด เพื่อหลังจากทำการอบนำมาทำการตรวจสอบสมบัติของฟิล์มจะช่วยลดปัญหาการผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลองได้

## 5.4 การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

เนื่องจากในการทำงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดทางด้านเวลาจึงทำให้การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไหเทเนียมได้ออกไซด์ไม่ได้ผลดังที่ต้องการ ดังนั้น จึงเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต เช่น

5.4.1 การทดลองจุ่มเคลือบที่จำนวนรอบที่อยู่ระหว่าง 7 ถึง 9 รอบ

5.4.2 ทำการทดสอบการเกิดปฏิกิริยาไฟต่ำตระกาสีสี

## เอกสารอ้างอิง

- [1] Hashimoto, K. Irie, H. Fujishima, A. **TiO<sub>2</sub> Photocatalysis a historical overview and future prospects.** Japanese Journal of Applied Physics. December 2005, Vol. 44, No. 12, pp. 8269-8285.
- [2] Kim, D.S., Han, S.J., YeopKwak, S. **Synthesis and photocatalytic activity of mesoporous TiO<sub>2</sub> with the surface area, crystallite size, and pore size.** Journal of Colloid and Interface science. August 2007, vol. 316, pp.85-91
- [3] รูปการประยุกต์ใช้งานไฟเทเนียมไดออกไซด์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.titanpe.com/library/kb2503.htm>
- [4] ณัฐพงศ์ ม่วงไตรรัตน์. (2554). การพัฒนาสารเคลือบไฟเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนบนเหล็กกล้าไร้สนิมวิทยานิพนธ์ วศ.ม. (วัสดุ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
- [5] โครงสร้างผลึกของเฟสไฟเทเนียมไดออกไซด์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://staff.aist.go.jp/nomura-k/english/itscgallery-e.htm>
- [6] Horn M., Schwerdtfeger C.F. and Meagher E.P., Zeitschrift für Kristallographie, 136, 273, 1972
- [7] Meagher E.P. and Lager G.A., The Canadian Mineralogist, 17, 77, 1979
- [8] ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์. (2550). ไฟเทเนียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมวิทยาลัยปีโตรเลียม และปีโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.vcharkarn.com/varticle/27809>
- [9] กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารกึ่งตัวนำไฟเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วย. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.vcharkarn.com/varticle/27809>
- [10] สารเจือไอออนคลอไรด์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558, จาก <http://gammaco.com/gammaco/th/3093040>
- [11] กระบวนการจุ่มเคลือบ. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.sdicompany.com/en/device/index.html>
- [12] นางสาวจุารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2557, จาก <http://www.dpim.go.th/articles/article?catid=125&articleid=3251>

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [13] นางสาวสุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558, จาก <http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4230/2/Fulltext.pdf>
- [14] พรนภา สุจริตารกุล. (2548). ไฟเทเนียมไดออกไซด์โพโตอะลิสต์กับชีวิตประจำวัน. สารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ, 40, 77.
- [15] Gopal, K., Mor, Shankar K., Paulose, M., Oomman, K. Varghese., and Craig, A. Grimes. (2006). "Use of highly-ordered TiO<sub>2</sub> nanotube arrays in dye-sensitized solar cells." *Nano Letters.* 6(2), 215-218.
- [16] เครื่อง X-ray Diffactometer. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557, จาก <http://share.psu.ac.th/blog/hs9ocb-service/25539>.
- [17] เครื่อง X-ray Diffactometer; XRD. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557, จาก <http://www.mfu.ac.th/center/stic/index.php/x-ray-analysis-instrumentmenu/item/87>.
- [18] เครื่อง UV-Visible spectrophotometer. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557, จาก <http://www.chemguide.co.uk/analysis/uvisvisible/spectrometer.html>.
- [19] เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557, จาก [http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Molecular-Spectroscopy/Cary-5000-UV-Vis-NIR/Publishing/Images/Large/cary\\_5000\\_uv-vis-nir\\_spectrophotometer\\_lg.png](http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Instruments-Systems/Molecular-Spectroscopy/Cary-5000-UV-Vis-NIR/Publishing/Images/Large/cary_5000_uv-vis-nir_spectrophotometer_lg.png)
- [20] ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์. (2556). การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคสีน้ำโรงเรわฟ. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2557, จาก [http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834\\_librae/File20131016163402\\_19731.pdf](http://librae.mju.ac.th/goverment/20111119104834_librae/File20131016163402_19731.pdf)
- [21] เอกพงษ์ พูนปุลก. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. บทที่ 7 สมบัติทางแสงของวัสดุกึ่งตัวนำ. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 , จาก <http://www.academia.edu/5206496/>
- [22] สมบัติเชิงแสงของวัสดุ. (2551). สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, จาก <http://physics.science.cmu.ac.th/courses/210351/Large%205.pdf>
- [23] วิชัย อนุรักษ์ฤกานนท์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. บทที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, จาก <http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/vichaipage/chap6.pdf>

## เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- [24] หัสดิภา หมายมั่น. (2555). เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค Scanning Electron Microscope: SEM, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2557, จาก <http://www.mfu.ac.th/center/stic/index.php/micro-analysis-instrument-menu/item/96-scaning-electron-microscrope.html>
- [25] ภาณุวัฒน์ คงอารามณ์. (2556). การพัฒนาพิล๊มบางชิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะtom บิสมัท โดยวิธีเคลือบผิวด้วยแรงเหวี่ยงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558, จาก <http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/4527/2/Fulltext.pdf>



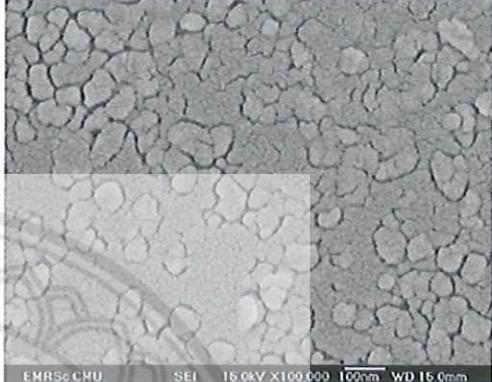
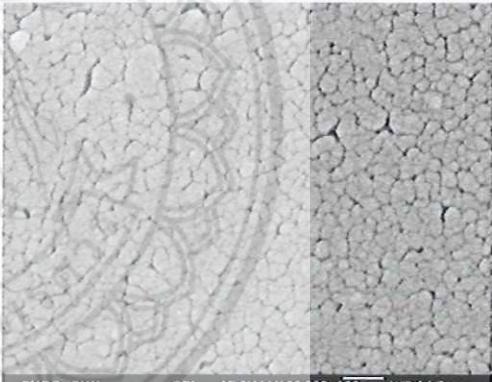
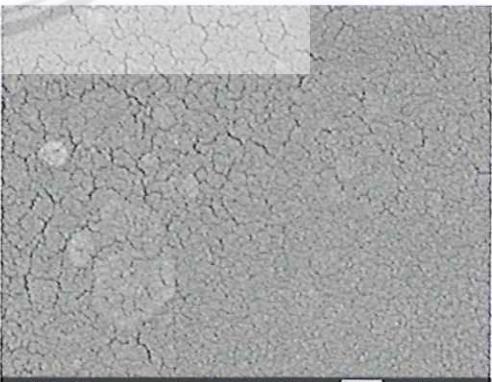


ภาควิชาเคมี

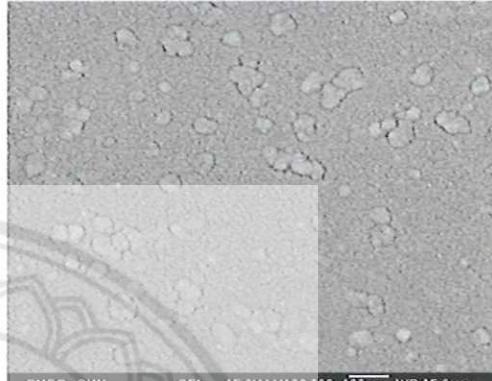
ภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู

(Scanning Electron Microscopy)

ตารางที่ ก.1 ภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 100,000 เท่า

สารเจือเหล็กคลอร์ไรด์ (III) ในเทเทเนียมไดออกไซด์ (ร้อยละ)	เหล็กคลอร์ไรด์(III) (กรัม)	ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ไม่ทำการเจือ	0	 EMRSc CMU SEI 16.0kV X100,000 100nm WD 15.0mm
2	0.056	 EMRSc CMU SEI 16.0kV X100,000 100nm WD 14.7mm
4	0.112	 EMRSc CMU SEI 16.0kV X100,000 100nm WD 15.0mm

ตารางที่ ก.1 (ต่อ) ภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 100,000

สารเจือเหล็กคลอไรด์ (III) ในไฟเทเนียมไดออกไซด์ (ร้อยละ)	เหล็กคลอไรด์ (III) (กรัม)	ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ได้จากการวิเคราะห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
6	0.168	 EMRSc CHU      SEI 15.0kV X100,000 100nm WD 15.0mm
8	0.224	 EMRSc CHU      SEI 15.0kV X100,000 100nm WD 15.2mm
10	0.28	 EMRSc CHU      SEI 15.0kV X100,000 100nm WD 15.3mm



Joint Committee on Powder Diffraction Standard: JCPDS

## JCPDS no. 00-004-0477 ของ Titanium dioxide

### Name and formula

Reference code: 00-004-0477  
 Mineral name: Anatase, syn  
 PDF index name: Titanium Oxide  
 Empirical formula: O<sub>2</sub>Ti  
 Chemical formula: TiO<sub>2</sub>

### Crystallographic parameters

Crystal system: Tetragonal  
 Space group: I41/amd  
 Space group number: 141  
 a: 3.7830 อั้งสตรอม  
 b: 3.7830 อั้งสตรอม  
 c: 9.5100 อั้งสตรอม  
 Alpha: 90.0000 องศา  
 Beta: 90.0000 องศา  
 Gamma: 90.0000 องศา  
 Calculated density (g/cm<sup>3</sup>): 3.90  
 Volume of cell (10<sup>6</sup> pm<sup>3</sup>): 136.10  
 Z: 4.00

### Status, Subfiles and Quality

Status: Marked as deleted by ICDD  
 Subfiles: Inorganic  
 Mineral  
 Quality: Indexed (I)

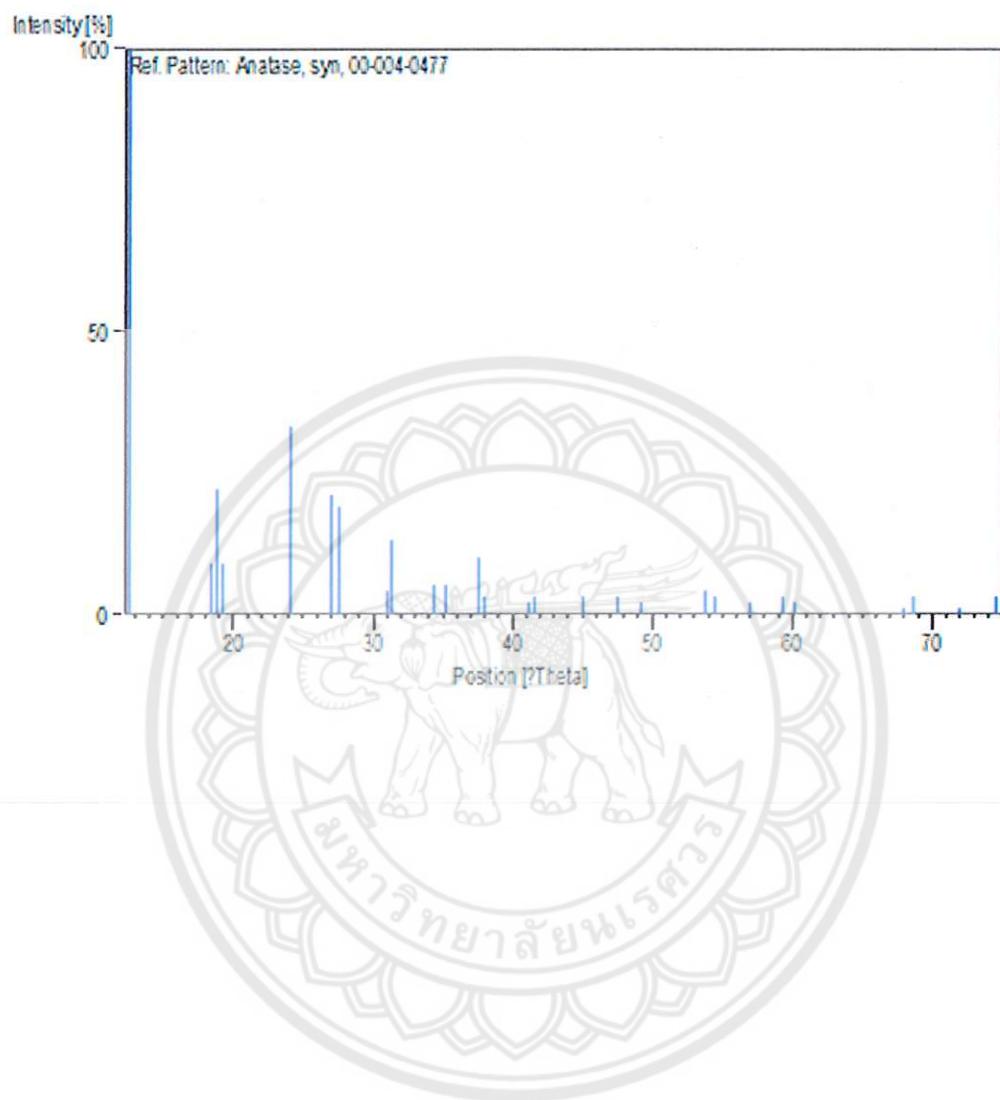
### References

Primary reference: Swanson, Tatge., *Private Communication*, (1950)  
 Additional pattern: Parker., *Z. Kristallogr.*, 59, 1, (1923)

**Peak list**

No.	h	k	l	d [Å]	2Theta[deg]	I [%]
1	1	0	1	3.51000	25.354	100.0
2	1	0	3	2.43500	36.884	9.0
3	0	0	4	2.37900	37.785	22.0
4	1	1	2	2.33600	38.507	9.0
5	2	0	0	1.89100	48.077	33.0
6	1	0	5	1.69900	53.922	21.0
7	2	1	1	1.66500	55.116	19.0
8	2	1	3	1.49400	62.075	4.0
9	2	0	4	1.48000	62.728	13.0
10	1	1	6	1.36700	68.596	5.0
11	2	2	0	1.33700	70.359	5.0
12	2	1	5	1.26400	75.094	10.0
13	3	0	1	1.25000	76.084	3.0
14	3	0	3	1.17100	82.267	2.0
15	3	1	2	1.16090	83.140	3.0
16				1.08690	90.261	3.0
17	3	2	1	1.04330	95.179	3.0
18	1	0	9	1.01730	98.436	2.0
19	3	1	6	0.95500	107.530	4.0
20	4	0	0	0.94610	109.014	3.0
21	3	2	5	0.91890	113.919	2.0
22	1	1	10	0.89600	118.568	3.0
23	2	2	8	0.88770	120.396	2.0
24	3	2	7	0.83110	135.896	1.0
25	4	1	5	0.82680	137.391	3.0
26	3	0	9	0.81000	143.974	1.0
27				0.79900	149.193	3.0

### Stick Pattern



## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นางสาวเมธีรัตน์ กะปุระ<sup>กุล</sup>  
ภูมิลำเนา 4/602 หมู่ 15 ต.วัดใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราวาทศิมชลิน  
จ.นครสวรรค์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: lovedadmommyk@gmail.com



ชื่อ นางสาวศศิธร เจริญปะละ<sup>กุล</sup>  
ภูมิลำเนา 229/2 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71  
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสายนำ้ผึ้ง  
ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  
สาขาวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: sasithorn.ben27@gmail.com